# フッ化マグネシウムナノ粒子を用いた 高性能反射防止膜の研究

村田 剛

フッ化マグネシウムナノ粒子を用いた高性能反射防止膜の研究

### 主論文

第1章	序論		1
	1-1	研究の背景	1
	1-2	研究の目的	5
	1-3	本論文の構成	13
	参考	文献	20
第2章	超低	屈折率層形成技術の確立	21
	2-1	成膜法の検討	21
	2-2	膜物質の選定	26
	2-3	超低屈折率化の方策	28
	2-4	オートクレーブ処理導入の効果	31
	2-5	膜の熱処理条件の検討	38
	2-6	結論	40
	参考	文献	41
第3章	紫外	光用反射防止膜の作製	43
	3-1	単層反射防止膜の成膜と特性評価	43
		3-1-1 膜厚と屈折率の関係	43
		3-1-2 分光透過特性評価	46
	3-2	多層反射防止膜の成膜と特性評価	48
		3-2-1 シミュレーション	48

		3-2-2	成膜と反射防止特性の確認	49
	3-3	レーザ・	ー耐久性の評価	51
	3-4	膜厚均-	一性の評価	53
		3-4-1	サンプル作製法	54
		3-4-2	測定方法	56
		3-4-3	測定結果	57
	3-5	結論		60
	参考	文献		62
第4章	可視	光用反射	す防止膜の作製	63
	4-1	成膜プ	ロセスの変更	67
	4-2	単層反	射防止膜の成膜と特性評価	73
	4-3	多層反響	射防止膜の成膜と特性評価	76
		4-3-1	シミュレーション	76
		4-3-2	成膜と反射防止特性の確認	79
	4-4	実用化		81
		4-4-1	ゴースト・フレアー防止効果の確認	81
		4-4-2	製品への適用	87
		4-4-3	適用製品分野の拡大	92
	4-5	結論		94
	参考	文献		96

第5章 ナノ粒子膜の濡れ性制御97

5-1 研究の背景97

5-2	研究の目的	105
5-3	サンプル作製法	106
5-4	測定方法	110
5-5	粒度分布評価	114
5-6	表面形状評価	116
5-7	光学特性評価	121
5-8	静的濡れ性評価	124
5-9	動的濡れ性評価	128
5-10	表面自由エネルギーの算出	137
5-11	結論	142
参考	文献	144

第6章	総括	146

6-1	本論文の総括	146

6-2 今後の反射防止膜の発展について 151

## 著者発表の論文・特許など

公表論文	153
投稿中論文	154
参考論文	154
雑誌報告	154
国内学会	155
国際学会	155
賞歴	156

日本特許	156
国際特許	157
著書	157

## 謝辞

謝辞	159
----	-----

主論文

フッ化マグネシウムナノ粒子を用いた高性能反射防止膜の研究

第1章

#### 序論

1-1 研究の背景

光線が物体に入射すると、媒質との屈折率差に応じて光の反射が生 ずる。光学ガラスの屈折率は一般的に 1.4~2.0 程度であるが、その表 面では、入射光の 4~8%のエネルギーが反射光として失われることと なる。多くの場合、このような反射光の発生は光線の利用効率を落と すだけでなく、ゴーストやフレアー(図 1)と呼ばれる迷光の発生の 原因となり、光学製品における大きな問題の一つとして知られている。 このような反射光の対策として、光の波としての性質を利用して、干 渉により反射光を打ち消す"反射防止膜"が多くの光学製品において 用いられている。

反射防止膜の起源は 1800 年代にさかのぼる。Fraunhofer は 1817 年 に、ガラスの化学処理による表面変質層の形成により、初めて反射防 止膜の作製に成功した<sup>[1]</sup>。Fraunhofer はガラス基板を酸に浸漬し、表 面に変質層(ヤケ)が生じることにより、反射率が低くなったと報告 している。また、Taylor は時間の経過した望遠鏡対物レンズの透過率 が向上することから、レンズ上に形成されるヤケが透過率向上に関係 していることを発見した<sup>[2]</sup>。これらの発見は偶然になされたものであ



図 1 写真撮影時に発生するゴーストおよびフレアー ((a) ゴースト, (b) フレアー)

るが、その後のヤケによる反射率低下現象の詳細な解析により、今日 の薄膜による反射防止原理の基礎が確立された。その後、光学薄膜は 干渉理論に基づいて、真空装置を用いて積極的にレンズ上に形成され るようになり<sup>[3-6]</sup>、計算技術の発達に伴ってその構成も単層から多層膜 へと進化し<sup>[7-10]</sup>、反射防止膜を含む、より性能の高い光学薄膜の形成 が可能となった。図2に一般的な反射防止膜の設計例をいくつか示す <sup>[11]</sup>。



- $n=1.64, nd=\lambda_0/4 \mid n_s=1.52$
- (d) 4 層模: 空気 | n=1.38,  $nd=\lambda_0/4$  | n=2.05,  $nd=\lambda_0/2$  | n=1.64,  $nd=\lambda_0/4$  | n=1.47,  $nd=\lambda_0/4$  |  $n_s=1.52$
- 図 2 反射防止膜の基本設計例((a) 単層,(b) 2 層,(c) 3 層, (d) 4 層)

これらの光学薄膜を支えてきたのは、ドライプロセスと呼ばれる真空 装置を用いた薄膜形成技術であり、金属、金属酸化物、ハロゲン化物 などが膜物質として用いられる。特に反射防止膜には光の吸収損失が 小さく化学的安定性の高い、酸化物やフッ化物が多用される。成膜方 式としては、抵抗加熱や電子ビーム加熱を利用して膜物質を蒸発・堆 積させる真空蒸着の他、電圧を印加することにより、加速させたイオ ンを膜材料に衝突させて、膜物質を飛散・堆積させるスパッタリング が主に用いられている。これらの手法により形成された薄膜は、一般

的に緻密な構造を持つことから、堆積する膜の屈折率は、理論密度を 有する膜物質固有の屈折率に近い値となる。薄膜を設計する際には、 あらかじめ取得したこれら膜物質の成膜データより、屈折率を求めて データベース化し、それらの中から目的に合わせた膜物質の組合せを 選択して、薄膜設計ソフトを用いて個々の膜厚の最適化を行う。多層 の反射防止膜を形成する場合、組み合わせる膜物質は通常 2~3 種類で、 屈折率差の大きい膜物質を組み合わせることが、性能の良い反射防止 膜を形成するポイントとなる。したがって、使用できる膜物質の屈折 率範囲を広くとれるかどうかが、反射防止膜の高性能化のカギとなる。 先に述べたように、ドライプロセスの場合は膜構造が緻密であるため に、膜の屈折率は使用する膜物質の種類で決まってしまうことから、 より多様な膜物質を使用できる成膜法が反射防止膜の高性能化におい て有利であると言える。このような理由から、現在の反射防止膜の形 成法としては、酸化物、フッ化物双方を使用可能な真空蒸着法が主流 となっている。ところが、近年光学基板材料の樹脂化に伴い、基板を 加熱しなくても、比較的緻密で密着力の良好な膜が得られるスパッタ リング法が注目されるようになり、重要性を増してきている。この他、 酸化インジウムスズ (Indium Tin Oxide: ITO) 膜のような導電性透明 薄膜などを形成する手段として、気化させた膜原料を化学反応により 基板上に堆積させる、化学気相析出(Chemical Vapor Deposition:CVD) 法なども用いられるようになってきた。CVD もまたドライプロセスの 一つである<sup>[12]</sup>。

1-2 研究の目的

現在、反射防止膜は光学系を有する多くの工業製品で用いられてい る。例えば、機械駆動部のアライメント、情報記録・読み取り、撮像・ 画像認識による各種検査、フォトリソグラフィー法による微細加工等 がその例として挙げられる。中でも、半導体産業における縮小投影露 光技術は、半導体の集積度を決定する重要なプロセスとなっている。 半導体に求められる性能(=集積度)は年々高まっており、露光に使 用される装置の投影レンズに求められる要求仕様もまた非常に高くな っている。半導体の回路は、原版の回路図をシリコンウェハー上に形 成された感光膜に縮小投影露光することにより形成されるため、その 集積度は投影レンズの解像度に大きく依存する。図3に露光装置の基 本構成を示すが、投影レンズの解像度を向上させるには、主に以下の 2つの手法がある。

1) 露光光源波長(λ)の短波長化

2) 投影レンズの開口数 (Numerical Aperture: NA) 拡大

図4に実際の半導体露光装置の露光光源波長およびNAと解像度の実 例を示すが、露光光源波長が短いほど、また、NAが大きいほど高い解 像度が得られることがわかる。

これらの手法により高解像度化を進めるには、単にレンズの加工技術向上だけでなく、そこに用いられる反射防止膜にも大幅な性能向上 が求められるが、そこには大きな問題があった。例えば、露光光源の



図3 半導体露光装置の基本構成



図4 半導体露光装置の露光光源波長および NA と解像度との関係

短波長化では、膜物質固有の屈折率分散に起因する屈折率の上昇という問題を解決しなくてはならない。

一般的に、物質の屈折率は対象とする光の波長が短くなるほど高く なるが、反射防止膜を形成する物質の屈折率が全体的に高くなると、 良好な反射防止特性の実現が困難となる。また、大 NA 化の場合は、投 影レンズの NA が大きくなるほど、レンズを通過する光線の最大入射角 も大きくなるという問題がある。投影レンズの NA と光線の最大入射角  $\theta_{max}$ との関係は図 5 の模式図のようになっており、簡易的に以下の式 (1)で表される。例えば、NA=0.7 の時、 $\theta_{max}$ は 44° であるが、NA=0.85 になると、 $\theta_{max}$ は 58° となる。

$$\theta_{max} = sin^{-1} NA \tag{1}$$

NA = 0.70 の時、
$$\theta_{max}$$
 = 44°  
NA = 0.85 の時、 $\theta_{max}$  = 58°  
NA = 0.90 の時、 $\theta_{max}$  = 64°  
NA = 0.95 の時、 $\theta_{max}$  = 72°大



図 5 投影レンズの各 NA における光線の最大入射角

さらに式(1)で示された NA と  $\theta_{max}$  との関係をグラフで表すと、図 6 のようになる。

ところが、このような大きな角度で入射する光に対して、十分な反 射防止を行うことはきわめて困難である。例えば、NA=0.85の投影レ ンズで残存反射1%以下という要求仕様があるとすると、従来法による 反射防止膜ではこの要求仕様を満たす反射防止膜の設計解は存在しな い。

そこで、本研究では種々のシミュレーションにより、投影レンズの 高性能化に対応可能な、これまでにない高い性能を有する反射防止膜 の実現性について検討を行った。図7は、最新の半導体露光装置の露 光光源である ArF レーザー(波長 193nm)を想定し、任意に変更可能 な仮想の屈折率を有する最上層を備えた5層反射防止膜の設計を行い、 各最上層の屈折率で得られた最も優れた設計解について、入射角58° (NA=0.85相当)での残存反射と最上層の屈折率との関係をグラフに したものである。ここで、NA=0.85は本研究を開始した際に、作製が 検討されていた投影レンズの最大 NA である。また、膜構成を単層では なく5層膜構成としたのは、レーザー耐久性を確保するために層数を 抑えつつ、より良好な角度特性を得るためであり、任意屈折率層を最 上層に配したのは、媒質(=空気)に接する層の屈折率が、最も反射 防止特性に影響を与えるからである。

図7からわかる通り、最上層の屈折率が1.11になるまでは、最上層 の屈折率が低いほど残存反射は小さく(=反射防止効果は高く)、1.11 の時に最も残存反射が小さくなり、さらに屈折率が低くなると残存反 射は増加に転じる。また、本結果より、NA=0.85の投影レンズにおい

て、要求仕様が"全ての角度範囲( $\theta \leq 58^{\circ}$ )において残存反射が1% 以下"であった場合、1.27以下の屈折率が実現できれば要求仕様を満 たすことができることがわかる。ところが、実際にはそのような低い 屈折率(超低屈折率)を有する膜物質は存在しない。これまで知られ ている193nmで使用可能な膜物質で、193nmにおける屈折率が最も低 いのはクライオライト(Na<sub>3</sub>AlF<sub>6</sub>)であるが、その値は1.39程度である。 そこで、本研究ではこのような実在しない低屈折率(超低屈折率)を 実現するために、膜の構造を制御して"見かけの屈折率"を下げる方 法を検討することとした。

物質の屈折率はその組成に固有のものであるが、膜の構造を粗とす ることにより、膜を構成する物質と媒質(空気)との中間的な屈折率 を実現することができる。例として、図8にLorentz-Lorenzの式<sup>[13-14]</sup> (式(2))より求めた、MgF<sub>2</sub>多孔質膜における MgF<sub>2</sub>の体積分率と膜の 見かけの屈折率との関係を示す。

$$(n_f^2 - 1) / (n_f^2 + 2) = p(n_b^2 - 1) / (n_b^2 + 2)$$
(2)

ここで、媒質の屈折率は1であり、n<sub>f</sub>は膜の見かけの屈折率、n<sub>b</sub>は膜 物質の屈折率、pは膜中の固体の体積分率(=膜の固体部分の体積/膜 の総体積)である。

例えば、先の屈折率 1.27 を  $MgF_2$ で実現するには、多孔質膜中の  $MgF_2$ の体積分率を 65%とすればよいことが図 8 よりわかる。ただし、ただ粗であれば良いというわけではなく、光の散乱を防ぐため、その構造単位は光の波長に対して十分小さくなくてはならない。そこで、本研

究では 1.30 以下の屈折率が実現でき、なおかつ、少なくとも数十 nm 以下の構造単位で構成された膜を形成可能な、新規の成膜プロセスを 実現することを目標とした。



図 6 式(1)より求めた NA と光線の最大入射角  $\theta_{max}$  との関係



図 7 5 層反射防止膜の最上層の屈折率と入射角 58° での残存 反射率との関係



図 8 Lorentz-Lorenz の式より求めた MgF<sub>2</sub>多孔質膜中の MgF<sub>2</sub>の体積分率と膜の見かけの屈折率との関係

### 1-3 本論文の構成

本論文は全6章から構成されており、第1章では本研究の背景、目 的および本論文の構成を、第2章,第3章,第4章および第5章では 研究成果を詳しく述べる。また、第4章では本研究の成果を実製品に 応用した事例についても詳しく報告する。また、第5章では、本技術 の特徴である、膜を構成する粒子径が変更可能である性質を利用して、 濡れ性の制御を行った成果について報告する。

以下に第1章,第2章,第3章,第4章,第5章および第6章の要 旨を述べる。

第1章では、本研究の背景、目的および本論文の構成について述べる。

本研究を開始した当時、半導体露光装置においては、解像度向上の ための周辺技術として、投影レンズに用いられる反射防止膜の性能向 上が求められていた。しかし、既存の成膜法で得られる反射防止膜の 性能は飽和状態にあり、性能向上のための新しい手法を考案する必要 があった。そこで本研究では種々のシミュレーションを行い、反射防 止膜に超低屈折率層を導入することが最も有効な手法であることを確 認し、紫外領域でも使用可能な 1.30 以下の屈折率を有する薄膜が作製 可能な手法の開発に着手した。

第2章では、超低屈折率層形成技術の確立について報告する。 超低屈折率層の導入が光学薄膜、特に反射防止膜の性能向上に有効

であることは従来知られていたが、その形成技術については実験室レ ベルにとどまっており、また、対象波長領域も可視光が中心で、光学 損失まで詳細に検討した例はほとんどなかった。本研究では、半導体 露光装置の投影レンズに適用可能な超低屈折率膜に求められる種々の 条件を検討し、その条件を満たすことができる可能性が最も高い成膜 法として、ゾル-ゲル法を用いた MgF。ナノ粒子膜の形成技術に着目し た。一般的にゾル-ゲル法により作製される薄膜のほとんどは酸化物で あるが、ごくわずかにフッ化物を用いた薄膜作製の報告が存在する。 膜を構成する物質としてフッ化物を用いた場合に期待できるメリット として、表面に水酸基を持たないため水分子の吸着による屈折率変化 が起きにくいことが挙げられる。酸化物においてはこの屈折率変化が 光学薄膜の分光特性の波長シフトや反射率変化の原因となり、光学特 性の不安定さの原因となるが、フッ化物の場合はその変化量が極めて 小さいことが期待された。さらに、フッ化物は酸化物よりも吸収端が より短い波長にあるものが多く、紫外光に対してより高い透過率が得 られることが期待された。酸化物でもArF波長(193nm)で十分な透過 が得られる物質はいくつか存在するが、F2波長(157nm)で十分な透過 率が得られる酸化物は存在しない。そこで本研究では種々のゾル-ゲル 法を用いたフッ化物作製技術の検討を行い、特に微細な粒子が安定し て得られる MgF。を膜物質として選択し、合成プロセスとしてフッ酸/ マグネシウム塩法を採用することとした。MgF。はバルクの屈折率が低 い上に吸収端波長が短く、紫外用光学薄膜の材料として好適な物質で ある。さらに、本研究では MgF, 粒子の結晶性向上などを狙い、独自の 工夫として、MgF<sub>2</sub>の合成プロセスにオートクレーブ処理を導入した。

その結果、ゾルーゲル法による MgF<sub>2</sub> 合成プロセスにオートクレーブ処 理を導入することで、一次粒子が空隙を残してネックで繋がった二次 粒子が形成され、さらに二次粒子が空隙を残して均一に堆積すること で、193nm で 1.25 以下という超低屈折率が得られるとともに、半導体 露光装置でも十分使用可能なほど光学損失が小さく、不均質の無い膜 が形成可能となることを見出した。さらに、オートクレーブ処理がゾ ルの粘度を低下させることにより、制御可能な膜厚範囲を拡大するこ とも見出した。

第3章では紫外光用反射防止膜の作製について報告する。

第2章で述べた方法により、超低屈折率膜の作製が可能となったこ とから、実際に反射防止膜を作製し、その分光反射特性や角度反射特 性の確認を行った。塗布ゾル濃度の変更により膜厚の異なる単層膜を 複数作製し、屈折率の算出を行ったところ、同じゾル原液から調製し た膜であれば、膜厚が異なってもほぼ同じ屈折率が得られることが確 認された。粉末エックス線回折(XRD)による結晶構造評価では、乾燥 ゲルからは MgF2のピークのみが検出され、オートクレーブ処理温度が 高いほどシャープなピークが観察された。透過型電子顕微鏡(TEM)に よる乾燥ゲル中の粒子観察では、直径数 nm から十数 nm の粒子が確認 され、オートクレーブ処理温度に応じて粒子径が大きくなっているこ とがわかった。同様の結果はゾルの粒度分布測定によっても確認され た。蛍石(CaF2)両面に単層反射防止膜を形成したサンプルでは、157nm で 99%以上という高い透過率が得られた。これは、ドライプロセスに より形成した F2 用反射防止膜と比較しても、遜色のない高い透過率で

あった。また、石英ガラス上に下地 4 層を蒸着で、最上層を本研究で 開発したゾルーゲル法で形成した 5 層反射防止膜について、角度反射特 性の測定を行ったところ、入射角 58° で 0.6%という低い反射率が得ら れた。これは従来のドライプロセスでは到底得られない低い値であり、 超低屈折率層導入による反射防止膜の性能改善効果が確認できた。さ らに、石英ガラス上に形成した MgF<sub>2</sub>ナノ粒子単層膜のレーザー耐久性 の評価を行ったところ、600 mJ/cm<sup>2</sup>/pulse のエネルギー密度で 5×10<sup>7</sup> ショットの照射の後でも、膜の破壊は認められなかった。また、¢ 300mm の合成石英ガラス上に MgF<sub>2</sub>ナノ粒子単層膜を形成した後に基板を割断 し、中心部,中間部,辺縁部の分光透過特性を比較したところ、全て 良く一致しており、膜厚・屈折率の面内均一性が高いことが確認され た。また、¢ 30mm 基板上に形成した膜と分光透過特性を比較したとこ ろ、ほぼ一致していた。これにより、¢ 30mm 基板を用いて、より大き な基板上に形成した膜の特性保証が可能であることが確認できた。

第4章では可視光用反射防止膜の作製について報告する。

写真のデジタル化が進み、記録媒体が銀塩フィルムから固体撮像素 子へと変化すると、撮影用レンズに形成される反射防止膜の性能不足 が指摘されるようになってきた。また、従来、広角レンズなど光線入 射角の大きなレンズにおいて、反射防止膜の角度特性の不足によるゴ ーストやフレアーの発生が問題となっていた。そこで、本研究では 3 章で報告した超低屈折率膜作製技術をベースに、バインダーを加えて 膜強度を向上することで、量産に対応可能な工程適用性を有する、可 視用反射防止膜の形成プロセスの開発を行った。その結果、単層膜で は膜の屈折率が任意に変更可能である性質を利用して、基板の屈折率 の平方根に一致する屈折率を有する膜の形成を可能とし、特定波長で 残存反射をほぼ0%に低減することに成功した。さらに、多層膜では下 地8層をスパッタリングで、最上層を本技術により形成した9層反射 防止膜を作製し、波長 650~450nm の範囲で平均反射率が 0.0098%とい う極めて低い反射率を実現した。これは従来の平均的な反射防止膜の およそ 1/10 以下という優れた値である。次いで、本技術を導入した 5 層反射防止膜を形成した平面ガラス基板 14 枚をダミー鏡筒に組み込 んだ試作品を作製し、従来コート品と比較したところ、従来コート品 では背面に設置した撮像素子が見づらかったのに対し、試作品では明 瞭に見通すことができた。さらに、本技術を導入した反射防止膜をズ ームレンズの適用可能なすべての面に形成した試作レンズを作製し、 従来コート品と撮影比較したところ、従来コートレンズでは太陽が画 面に入るような厳しい光線条件下では多くのゴーストが発生したのに 対し、試作レンズではほとんどゴーストは発生しなかった。また、試 作品撮影画像のシャドー部では黒の締りが良くなってコントラストが 向上しており、フレアー低減効果も確認された。このような優れた光 学特性とその高い量産性により、本技術は"ナノクリスタルコート" と命名され、2005年に初めて一眼レフ用交換レンズに適用された。現 在ではナノクリスタルコートを適用したカメラレンズは 20 機種にお よび、適用製品も顕微鏡用対物レンズにまで広がっている。

第5章では、MgF<sub>2</sub>ナノ粒子膜形成技術と撥水処理を組み合わせ、膜

性状と濡れ性との関連を調べた結果について報告する。

近年、生体模倣(バイオミメティクス)技術の一分野として、材料 表面の濡れ性制御技術が注目を集めている。特に、化学的な表面処理 と微細構造の付与による超撥水性の実現は、降雨時の窓の視認性向上 や防汚性の付与などへの応用が期待され、盛んに研究されている。そ こで、本研究では粒子径が変更可能な MgF。ナノ粒子膜とフルオロアル キルシラン(fluoroalkyl silane : FAS)を組み合わせ、膜の表面粗さ と静的・動的濡れ性との関係を評価することとした。異なる温度でオ ートクレーブ処理を行った複数の MgF<sub>2</sub>ゾルに SiO<sub>2</sub>系バインダーを添加 し、それらを合成石英ガラス基板上に塗布することにより、ナノ粒子 膜を形成した。次いで、それらのサンプルに FAS 処理を行うことで撥 水性を与えた後、静的および動的濡れ性の評価を行った。オートクレ ーブ後のゾルに含まれる MgF。ナノ粒子の平均粒子径は、オートクレー ブ処理温度が高いほど大きかった。得られたナノ粒子サンプルはいず れも透明で、FAS 処理による明確な外観の変化は認められなかった。 膜の RMS 表面粗さの測定では、ゾルのオートクレーブ処理温度が高い ほど膜の表面粗さが大きくなっていることが確認された。また、FAS 処理は膜の表面粗さに影響を与えないことも確認された。得られたサ ンプルの、水およびジョードメタンの静的接触角を測定したところ、 いずれの液体に対しても、ナノ粒子サンプルではゾルのオートクレー ブ処理温度が高いほど、大きな接触角を示すことが明らかとなった。 ただし、水については、100℃オートクレーブ処理ゾルから調製した FAS 処理ナノ粒子サンプルの接触角は、FAS 処理石英ガラスサンプルの 接触角よりも、わずかに小さかった。この原因として、ナノ粒子サン

プルの FAS による被覆が完全ではないことが考えられた。一方、滑落 法による水に対する動的濡れ性評価では、オートクレーブ処理温度が 高いほど、得られるナノ粒子サンプルの水滴転落角が大きくなること が明らかとなった。その原因として、膜表面の微細構造の水滴への突 き刺さりと、毛管現象によるピン止め効果が考えられた。また、同じ ナノ粒子サンプル上であれば、水滴の付着エネルギーは水滴サイズに 関わらずほぼ同じであった。さらに、転落角の測定結果から前進角 θ<sub>a</sub> と後退角 θ<sub>r</sub>の差Δθ を求めたところ、FAS 処理石英ガラスのΔθ が最 も小さく、ゾルのオートクレーブ処理温度が高いサンプルほど大きな Δθ を示した。また、膜の表面粗さとΔθ との関係を調べたところ、 両者の間には比例関係があることが確認された。

第6章では本論文の各章で述べた研究成果をまとめ、今後の反射防 止膜形成技術の展望について述べる。 参考文献

[1] J. v. Fraunhofer: Joseph von Fraunhofer's Gesammelte Schriften, München (1817).

[2] H. D. Taylor: On the Adjustment and Testing of TelescopicObjectives, T. Cooke (1891).

[3] P. Rouard, Coutes Rendus de l'Academie de Science, 195, 869-872 (1932).

[4] G. Bauer, Ann. Phys., **19**, 434-464 (1934).

[5] A. H. Pfund, J. Opt. Soc. Am., **24**, 99-102 (1934).

[6] J. Strong, J. Opt. Soc. Am., 26, 73-74 (1936).

[7] W. Geffcken, ドイツ特許 716, p. 153 (1939).

[8] Thelen, Alfred, The pioneering contributions of W Geffcken, in Thin Films on Glass, H. Bach and D. Krause, Editors., Springer-Verlag: Berlin, Heidelberg., pp. 227-239 (1997).

[9] A. Herpin, Acad. Des Scie., **21**, 182-183 (1948).

[10] L. I. Epstein, J. Opt. Soc. Am., 42, 806-810 (1952).

[11] 小倉繁太郎:"生産現場における光学薄膜の設計・作製・評価技術",技術情報協会,pp. 249-251 (2001).

[12] 李正中,光学薄膜と成膜技術,アグネ技術センター, pp. 301-339 (2002)

[13] M. Born and E. Wolf, "Principles of Optics", p. 87, Pergamon Press (1975).

[14] C. J. Brinker and G. W. Scherer, "Sol-Gel Science", p. 803, Academic Press (1990).

第2章

超低屈折率層形成技術の確立

2-1 成膜法の検討

波長より小さな微細構造を利用した多孔質反射防止膜の構造として は、既に種々のタイプのものが提案されている。従来の緻密な膜も含 め、代表的な反射防止膜の微細構造をまとめた結果を図9に示す<sup>[1]</sup>。



図 9 反射低減のための基本構造((a)低屈折率単層膜,(b) 誘電体多層膜,(c)多孔質低屈折率膜,(d)傾斜多孔質膜, (e)微小突起配列(モスアイ構造),(f)不規則突起配列) (a),(b)は最も一般的な誘電体反射防止膜の構造である。(c),(d) は多孔質な構造をもつ反射防止膜、(e),(f)は基板から媒質側に向か って構造が小さくなる突起構造である。(e),(f)の構造は自然界にも 見出され、特に(e)の構造は蛾の目の表面構造に似ていることから「モ スアイ(moth-eye)構造」と呼ばれ、良く知られている。工業的には、 (b)のように屈折率の異なる層を重ね合わせ、干渉効果により反射を低 減させる方法が主流となっている。(a)の手法では、幅を持った波長帯 域で反射防止効果が得られないうえ、角度反射防止特性が低いが、多 層膜(b)では、それぞれの層厚を最適化することにより、ある程度の波 長帯域において低反射が得られ、さらに、入射角度範囲についても、 直入射からそれなりの斜入射の光線まで反射防止効果が得られる。し かし、反射防止の波長帯域も角度特性も、使用される膜物質固有の屈 折率に大きく依存し、特に角度特性については、大きな入射角の光に 対し十分な反射防止性能を得ることは不可能である。

これに対し、(c),(d)では膜の構造を粗とすることで、"見かけの屈 折率"を膜物質本来の屈折率より低くすることができるため、反射防 止膜の角度特性を飛躍的に改善することができる。また、反射防止膜 の波長帯域を広くすることも可能である。さらに、膜の充填密度を変 更することにより、同じ膜物質で異なる屈折率を実現することも可能 であり<sup>[2]</sup>、構造(c)の場合でも、後述するように単層膜において特定波 長での反射を 0%とすることが可能となる。

(e),(f)のような微小突起を基板上に設けることでも、反射低減は 可能である<sup>[3]</sup>。構造(e)においては、構造の周期が光の回折が生じない 程度に小さければ、(d)の場合と同様に平均屈折率が膜の深さ方向に

徐々に変化することとなる(傾斜屈折率膜)。しかし、実際には規則配 列した微細構造を作製する技術は発展途上にあるため、大面積の基板 上に回折が発生しないほど小さな突起を形成することは未だ困難であ り、しばしば"スミア"と呼ばれる回折光による光の滲みが発生する (図 10)。図 10-(a)は、モスアイシートに背面からグリーンレーザー を照射した際に発生したスミアを撮影したものである。また、図 10-(b) は、モスアイシートをカメラのレンズ前面に配置し、LED 光源を撮影 した際に光源像近傍に発生したスミアである。これらのスミアは、い ずれもモスアイシート上の規則配列構造に起因する回折現象により発 生したものである。一方、構造(f)であれば回折によるトラブルの発生 を防止することができるが、構造の形成技術が確立されていないこと は構造(e)と同様である。さらに、これら(e),(f)の構造は、コストや 材料の選択性、基板形状の適応性など課題が多く、短期間での開発は 困難である。

上記膜構造の特徴を踏まえ、本研究では投影レンズ用高性能反射防 止膜の作製法を検討するにあたり、以下に挙げるポイントに留意しな がら成膜法・膜構造の選定を行った。

1) 開発期間が短いこと

2) 真空紫外領域においても透過率の高い膜が実現可能であること

3) 石英ガラス・蛍石(CaF<sub>2</sub>)に適用可能なプロセスであること

4) レンズ形状による制約を受けにくいプロセスであること

5) できるだけ低い屈折率が実現可能であること

6) 環境による屈折率変化が小さいこと

- 7) シンプルで工程適用性の良いプロセスであること
- 8) 膜の構造単位が光の波長に対して十分小さく、ランダム構造で あること

上記ポイントを考慮して本研究で選択したのは、ゾルーゲル法による フッ化物ナノ粒子膜の作製であった。ウェットプロセスの一つである ゾルーゲル法は、液体(ゾル)からゲルを経て材料を合成することを特 徴とし、以前から粗な構造を形成するのに適した方法として知られて おり<sup>[4-6]</sup>、屈折率 1.30 以下の超低屈折率を有するバルクや膜の作製報 告も数多くなされてきた。



図 10 モスアイ構造による回折現象で発生するスミア((a) モ スアイ基板にグリーンレーザーを照射した際に観察されるスミ ア,(b)モスアイ基板を通して撮影された画像上で光源近傍に 発生するスミア)

### 2-2 膜物質の選定

しかし、ゾル-ゲル法により合成される材料のほとんどは、二酸化ケ イ素(Si0,)を中心とする酸化物であり、光学薄膜として使用した場 合、水分の吸着による屈折率上昇や膜の特性シフトが生じるという問 題が知られていた。また、酸化物は真空紫外領域(λ≦200nm)におい ては光の吸収損失が大きく、十分な透過率が得られないという問題も ある。一方、フッ化物はゾル-ゲル法での作製報告が極めて少ないもの の<sup>[7-9]</sup>、真空紫外領域でも高い透過率を有し、表面に水酸基(-OH)を 持たないため、水分の吸着による特性シフトがほとんどないという特 徴がある。例えば、Thomas は塩やアルコキシドからゾル-ゲル法を用 いて MgF,や CaF,の単層反射防止膜を作製し、両面コートした合成石英 ガラスや CaF, 基板で 100%に近い透過率が得られることを示している (図 11)<sup>[10]</sup>。これは、可視領域において 1.20 程度までの超低屈折率 層が実現されているためであり、フッ化物においてもゾル-ゲル法で多 孔質膜の作製が可能であることを示している。ただし、彼らの評価は 800nm~200nm までの可視~紫外領域にとどまっており、真空紫外領域 での特性については示されていなかった。そこで本研究では、特に光 の透過性が良く、屈折率が低いとの理由から、Thomas が用いたのと同 じアルカリ土類フッ化物、特に MgF。と CaF。を対象物質として、ゾル-ゲル法と組み合わせることにより、ナノサイズの微細粒子(=ナノ粒 子)で粗な構造を形成可能な成膜法の検討を開始した。その結果、CaF。 よりも MgF。の方が微細で均一な粒子が得られやすいことがわかり、 MgF<sub>2</sub>について開発を進めることとした。また、単に微細な粒子が得ら

れるだけでなく、MgF<sub>2</sub>の方が CaF<sub>2</sub>よりもバルクでの屈折率が低いため、 両者を用いて同じ体積分率を有する多孔質膜が得られた場合、MgF<sub>2</sub>の 方がより低い膜の見かけの屈折率が得られるというのも選択の理由の ひとつである。図7に示した通り、屈折率1.11までは反射防止膜の最 上層の屈折率が低いほどより高い反射防止効果が得られるため、可能 な限りより低い屈折率が得られる条件を選択することが重要である。



図11 合成石英ガラス基板両面にゾル-ゲル法により MgF<sub>2</sub>単 層膜を形成したサンプルの分光透過率

ゾル-ゲル法の特徴として、反応プロセスの選択幅が広いということ が挙げられる。MgF<sub>2</sub>を合成する場合においても、その代表的なプロセ スとして以下の3つのプロセスが知られている。なお、各プロセスで 示した反応例以外にも、他のさまざまな化学物質の組合せが可能であ る。

1) フッ酸/マグネシウム塩法

反応例  $2HF + MgC1_2 \rightarrow MgF_2 + 2HC1$ 

- フッ酸/アルコキシド法
  反応例 2HF+Mg(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>0)<sub>2</sub>→MgF<sub>2</sub>+2C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>0H
- 3) トリフルオロ酢酸/アルコキシド法
  - 反応例  $2CF_{3}COOH + Mg(C_{2}H_{5}O)_{2} \rightarrow Mg(CF_{3}COO)_{2} + 2C_{2}H_{5}OH$  $Mg(CF_{3}COO)_{2} \rightarrow 熱分解 \rightarrow MgF_{2}$

本研究では、これらの反応のうち、得られる膜の種々の物性評価結 果より、2)のフッ酸/マグネシウム塩法を主たるゾル調製法として採 用することとした。さらに、検討を進める中で、より低い屈折率の膜 を実現するためには、ゾル調製プロセスにオートクレーブ処理を導入 することが有効であることを見出した。図12にナノ粒子膜の製造プロ セスを示す。オートクレーブとは内圧を上げることが可能な耐圧容器 で、加圧の他に加熱も可能なものもあり、化学合成の反応容器や医療 器具の滅菌などに広く用いられている。オートクレーブ処理を行うこ とによりゾルは透明となり(図 13)<sup>[11]</sup>、1年以上の長期間にわたる保存の後でも、沈殿が発生することなくそのまま使用することが可能となった。これは安定した光学特性の反射防止膜を作製するにあたり、 重要なポイントである。さらに、オートクレーブ処理を行うとゾルの 粘度が下がることから、従来よりも高い濃度までゾルを濃縮すること が可能となり、一度に塗布できる膜厚を厚くすることが可能となった。 そのため、100nmを超える膜厚の層も、一度の成膜作業で形成可能と なった。これは紫外光だけでなく、可視光用反射防止膜を形成する場 合でも十分な厚さである。




図 13 オートクレーブ処理後のゾル

2-4 オートクレーブ処理導入の効果

図 14 に、本手法で形成した膜を構成する MgF<sub>2</sub>粒子(一次粒子)の 透過型電子顕微鏡(TEM)写真を示す<sup>[12]</sup>。観察は、アルコールで希釈 したゾルをカーボンメッシュ上に滴下し、乾燥させた後に行った。全 サンプル中で、オートクレーブ処理を行わなかったゾル中の MgF<sub>2</sub>粒子 が最も小さく、直径は 2~3nm 程度であった。オートクレーブ処理を行 ったゾルの MgF<sub>2</sub>粒子は未処理のものよりも大きく、180℃オートクレ ーブ処理を行ったゾルの MgF<sub>2</sub>粒子が最も粒子径が大きく、7~10nm 程 度であった。また、さらに観察倍率を上げると、個々の粒子中に明瞭 な格子模様が確認できた。これは、個々の MgF<sub>2</sub>粒子が高度に結晶化し ていることを示している。フッ化物はイオン結合性が強いため、溶液 中で容易に結晶化するものと思われる。

図 15 には、オートクレーブ処理を行っていないゾルと、180℃で 24 時間オートクレーブ処理を行ったゾル中に分散した MgF<sub>2</sub>粒子の粒度分 布測定結果を示す<sup>[12]</sup>。ゾル濃度はともに 1.0mass%とした。180℃でオ ートクレーブ処理したゾル中の MgF<sub>2</sub>粒子は、オートクレーブ未処理の ゾル中の MgF<sub>2</sub>粒子に比べ、平均粒子径 (D<sub>a</sub>)が大きく、また、粒子径 の分布範囲も広くなっていた。さらに、単に粒径分布範囲が広がるだ けでなく、小さな粒径の粒子数も増加しており、新たな核形成も起こ っていることが推測された。図 16 に粉体の凝集形態の模式図を示すが、 粒度分布測定で評価しているのは二次粒子径であり、図 14 と図 15 に 示した結果から、オートクレーブ処理にはゾル中の MgF<sub>2</sub>粒子の一次粒 子径および二次粒子径を増大させる効果があることがわかる。これは、



図 14 乾燥ゲル中の  $MgF_2$ 粒子の TEM 像((a) オートクレーブ処理 無し、(b) 140 C オートクレーブ処理、(c) 180 C オートクレーブ 処理)



図 15 オートクレーブ未処理および 180 Cオートクレーブ処理 ゾル中の MgF<sub>2</sub> 粒子の粒度分布比較(ゾル濃度: 1.0mass%, no autoclaving: オートクレーブ処理無し, 180 C: 180 Cオートク レーブ処理)



図 16 粉体の凝集形態模式図

オートクレーブ処理が、ゾル中の未反応原料の反応を促進するためで あると考えられる。また、二次粒子径は図 14 に示された一次粒子より も大きな範囲まで分布しており、一次粒子が複数凝集して二次粒子を 形成していることがわかる。さらに、図 14 では個別の一次粒子の輪郭 が確認できることから、一次粒子が空隙を残してネックで繋がること で二次粒子が形成されていると考えられる。ただし、180℃オートクレ ーブ処理を行った後でも、二次粒子径は真空紫外領域(λ=200~150nm) の光の波長よりも十分小さく、反射防止膜として使用するには問題の 無い大きさであった。もし、膜の構造単位が対象光の波長より大きく なると、ミー散乱<sup>[13]</sup>が発生し、レンズの結像性能を著しく損なうこと となる。また、仮に構造単位が対象波長よりも小さくても、両者が近 い値であるとレイリー散乱<sup>[14]</sup>が発生することから、構造単位は基本的 に小さければ小さいほど良いといえる。

図 17 には、ゾルを乾燥して得られた粉体の粉末エックス線回折(XRD) の結果を示す。オートクレーブ処理を行っていない MgF<sub>2</sub>粒子の回折ピ ークはブロードであるが、オートクレーブ処理を行うことによりピー クはシャープとなり、さらにオートクレーブ処理温度が高くなると、 回折ピークもよりシャープとなった。また、オートクレーブ処理温度 が高くなると、小さな回折ピークが現れた。ピークはいずれも MgF<sub>2</sub>の 回折線と一致し、MgF<sub>2</sub>のみが形成されていることが確認された。先に 示した TEM による観察結果では、オートクレーブ処理により



図 17 MgF<sub>2</sub>乾燥ゲルの XRD 評価結果((a) オートクレーブ処理 無し,(b) 120℃オートクレーブ処理,(c) 180℃オートクレー ブ処理)

MgF<sub>2</sub>の一次粒子径が大きくなることが確認されていることから、オー トクレーブ処理温度の上昇と共にピークがシャープになったのは、結 晶化が進んだだけでなく、結晶子径が増大した影響もあるものと考え られる。

図 18 には、石英ガラス基板上に形成した膜の割断面の走査型電子顕 微鏡 (SEM)写真を示す<sup>[15]</sup>。膜は、粒子が粗に堆積することにより形 成されているが、粒子径は先に TEM で観察された一次粒子よりも大き かった。これは、一次粒子が複数個凝集して形成された二次粒子であ り、この二次粒子が空隙(空孔)を残して堆積することにより、多孔 質膜が形成されていることが観察結果からわかる。この二次粒子径も 反射防止の対象となる光の波長(λ≧150nm)に比べると十分小さく、 散乱の発生も低く抑えられることが期待された。さらに、膜中の空孔 は極端に大きなものがなく、ほぼ同じ大きさに見えるが、空孔サイズ が小さく揃っていることも、散乱を低く抑える上で重要である。仮に



図 18 石英ガラス基板上に形成した膜の割断面の SEM 像(基板: 合成石英ガラス, 膜構成:単層, (a) オートクレーブ処理無し, (b) 120℃オートクレーブ処理, (c) 180℃オートクレーブ処理) 粒子径が小さくても空孔が大きければ、酸化物で形成したエアロゾル のように散乱が大きくなり、光学損失の原因となる。

上記実験により得られた膜の屈折率を、反射率および透過率より求 めたところ、1.41~1.17(λ=193nm)の範囲の膜が形成可能であるこ とがわかった。屈折率はオートクレーブ処理温度を変更することによ り制御可能であり、高い温度でオートクレーブ処理を行うほど低い屈 折率が得られた。これは粒子径が増大するとともに、ネックの成長な どで、成膜時に粒子の滑りによる緻密化が生じるためではないかと推 測される。なお、本手法により実現可能な屈折率範囲における MgF<sub>2</sub>の 体積分率を、先に示した図 8 より求めると、およそ 40~95vol.%であ ることがわかる。

以上説明した通り、オートクレーブ処理をゾル調製プロセスに導入 することにより、得られるゾルの性状を変更することができるが、そ の理由の一つとして、分散媒の化学変化が挙げられる。オートクレー ブ処理後のゾルの匂いが変化していることに気付いたことから、処理 前後のゾル組成をガスクロマトグラフィーにより分析・比較したとこ ろ、オートクレーブ処理後のゾルには酢酸メチルが含まれていること が明らかとなった(図 19)。これは、オートクレーブ処理中に、分散 媒であるメタノールと、原料由来の酢酸とが反応することにより形成 されたものである。この酢酸メチルの形成が酢酸濃度を下げ、さらに 酢酸の会合を妨げることで、ゾルの粘度低下に貢献しているものと考 えられる。本結果より、オートクレーブ処理は単に MgF<sup>2</sup>粒子の粒径を 変化させるだけでなく、ゾルの化学組成をも変化させることが確認さ れた。



図 19 ガスクロマトグラフィーによるオートクレーブ後のゾル 分散媒の組成評価結果

#### 2-5 膜の熱処理条件の検討

成膜後のサンプルは、膜表面の残留溶媒などを除去するためにオー ブン中で加熱乾燥を行ったが、加熱が膜強度に影響を与える可能性が あることから、ナノインデンテーションによる硬度および弾性係数の 測定を行った。硬度測定においては、一般的に膜厚が圧子の押し込み 深さの10倍以上ないと、基板の影響が現れるといわれているため、MgF<sub>2</sub> ナノ粒子層の膜厚は120nmとした。また、当初、成膜後の加熱は300℃ までの温度範囲で行っていたが、250℃以上で加熱したサンプルは透過 率が低下することがわかったため、途中から加熱温度範囲を 200℃以 下として評価を進めた。透過率低下の原因としては、大気中の酸素と MgF<sub>2</sub>が反応し、酸化物が形成されたことが考えられる。

硬度および弾性係数の測定結果を表1に示す。測定は無加熱サンプ ルおよび200℃までの3条件で加熱したサンプルについて行ったが、 無加熱サンプルと100℃加熱サンプルの硬度は同じであったのに対し、

Heating Temperature (°C)	as prepared	100	150	200
Max Load (µN)	4	4	4	4
Max Depth (nm)	8	8	7	7
Hardness (GPa)	0.52	0.52	0.66	0.66
Elastic Coefficient (GPa)	27.6	32.0	33.5	29.8

表1 加熱処理が MgF<sub>2</sub>ナノ粒子膜の強度に及ぼす影響

基板:合成石英ガラスウェハー (厚さ=0.525mm) 膜厚:120nm 測定装置:島津 SPM-9500J2 + Hysitron Triboscope 圧子:Berkovich型 ダイヤモンド圧子 (先端角 142.3°) 150℃加熱サンプルではわずかに上昇していた。また、180℃加熱サン プルの硬度は 150℃加熱サンプルと同じであった。弾性係数について は、150℃までは加熱温度の上昇とともに増加したが、200℃ではわず かに低下した。その原因は明らかではないが、同じ二次粒子内に存在 する一次粒子同士のわずかな焼結により、二次粒子の体積収縮が生じ、 二次粒子間の空隙がわずかに開いたことが考えられる。それにより、 膜の硬度はあまり変化しないが、二次粒子同士の接点が減少すること で、弾性係数が低下したのではないかと考えられる。

以上の結果を受け、わずかでも膜の硬度を上げるために、以後の評価では成膜後の加熱を全て 150℃で行うこととし、各種のサンプル作製・評価を行った。

2-6 結論

本研究では、多孔質膜の作製法として好適なゾルーゲル法で MgF<sub>2</sub> ナ ノ粒子を形成し、さらにオートクレーブ処理を行うことにより、一次 粒子が空隙を残してネックで繋がった二次粒子が形成され、さらに二 次粒子が空隙を残して均一に堆積することで、193nmで1.25以下とい う超低屈折率が得られるとともに、半導体露光装置でも十分使用可能 なほど光学損失が小さく、不均質の無い膜が形成可能であることを見 出した。MgF<sub>2</sub>粒子の粒子径はゾルのオートクレーブ処理温度の上昇に 伴って大きくなり、膜の屈折率もそれに伴って低くなった。オートク レーブ処理温度の変更により実現可能な膜の屈折率範囲は、1.41~ 1.17(λ=193nm)であり、Lorentz-Lorenzの式より求めた膜中の MgF<sub>2</sub> の体積占有率は 40~95%であった。さらに、オートクレーブ処理がゾ ルの粘度を低下させることにより、制御可能な膜厚範囲を拡大するこ とも見出した。また、成膜後の加熱処理において、150℃以上の温度で 処理することにより、膜の硬度が上昇することが確認された。

## 参考文献

[1] 菊田久雄,光学,40,2-10 (2011).

[2] K. Cathroa, D. Constablea and T. Solagaa, Sol. Energy, 32, 573-579 (1984).

[3] S. Wilson and M. Hutley, Opt. Acta, **29**, 993-1009 (1982)

[4] S. S. Kistler, Nature, **127**, 741 (1931).

[5] G. A. Nicolaon and S. J. Teichner, Bull. Soc. Chem. Fr., 5, 1906-1911 (1968).

[6] B. E. Yoldas, Appl. Opt., **19**, 1425-1429 (1980).

[7] Herve G. Floch, Philippe F. Belleville, Jean-Jacques Priotton, Philippe M. Pegon, Corinne S. Dijonneau and Jacques Guerain, Am. Ceram. Soc. Bull., **74**, 48 (1995)

[8] P. H. Joosten, P. Heller, H. J. P. Nabben, H. A. M. van Hal,
Th. J. A. Popma and J. Haisma, Applied Optics, 24, 2674 (1985)
[9] R. E. Riman, M. Dejneka, J. Ballato and E. Snitzer, Eur. J.
Solid State Inorg. Chem., 32, 873-882 (1995).

[10] I. M. Thomas, Applied Optics, 27, 3356-3358 (1988).

[11] T. Murata, H. Ishizawa, I. Motoyama and A. Tanaka, Appl. Opt.,47, 246-250 (2008).

[12] T. Murata, H. Ishizawa, I. Motoyama and A. Tanaka, J. Sol-GelSci. Technol., 32, 161-165 (2004).

[13] G. Mie, Ann. d. Physik, **25**, 377-445 (1908).

[14] L. Rayleigh (J.W. Strutt), Philos. Mag., 16, 274-279 (1871).

[15] T. Murata, H. Ishizawa, I. Motoyama and A. Tanaka, Appl. Opt., 45, 1465-1468 (2006).

## 第3章

## 紫外光用反射防止膜の作製

3-1 単層反射防止膜の作製と特性評価

オートクレーブ処理の導入は、単に得られる膜の屈折率を低くでき るだけでなく、処理温度(あるいは圧力)を変更することにより、1.41 ~1.17(λ=193nm)の間で任意に膜の屈折率を変更できるというメリ ットももたらした。さらに、オートクレーブ処理を行うとゾルの粘度 が下がることから、従来よりも高い濃度までゾルを濃縮することが可 能となり、一度に塗布できる膜厚を厚くすることが可能となった。そ こで、本研究では次のステップとして、MgF<sub>2</sub>ナノ粒子膜を用いた紫外 光用反射防止膜作製の可能性を確認した。以下にその結果を詳細に説 明する。

3-1-1 膜厚と屈折率の関係

ウェットプロセスにより薄膜を形成する場合、膜厚は使用する液の 濃度を変更することにより制御するのが一般的である。しかし、場合 によっては成膜に用いる液の濃度を変更することにより、得られる膜 の性質が変わることも考えられる。特に光学薄膜を形成する場合は、 たとえ機械膜厚が同じであっても、膜の屈折率が異なると光学光路長 は異なる。そこで、本研究では2種類のゾル原液の濃度を変更し、得

られる膜の機械膜厚と屈折率との関係を調べた。図 20 にその結果を示 す。実験には濃度変更前の原液として、オートクレーブ処理を行って いないゾルと、140℃で 24 時間オートクレーブ処理を行ったゾルを用 いた。

本図からわかる通り、オートクレーブ処理の有無にかかわらず、同 じ原液(原料ゾル)から調製された膜であれば、膜厚(塗布濃度)が 異なってもほぼ同じ屈折率が得られることがわかる。これは、塗布液 濃度の変更により得られる膜の膜厚のみを変更できることを示してお り、本技術を実用化する上で大きなアドバンテージとなる。なお、膜 厚が薄くなると屈折率のばらつきが若干大きくなるように見えるが、 これは、膜厚が薄くなり過ぎると反射率と透過率から屈折率を見積も る際の精度が低下するためであると考えられる。



図 20 異なる濃度のゾルより調製した単層膜の膜厚と屈折率 との関係(基板:合成石英ガラス,膜構成:単層)

3-1-2 分光透過特性評価

図 21 には、CaF<sub>2</sub> 基板両面に本手法を用いて単層反射防止膜を形成し たサンプルの、真空紫外領域での透過率測定結果を示す<sup>[1]</sup>。ある波長 に対し、単層膜で 100%の透過率を得るには、その波長における膜の屈 折率を基板の屈折率の平方根に一致させなくてはならない。そのため、 本サンプルの作製では、膜の屈折率が CaF<sub>2</sub>の 157nm での屈折率である 1.561 の平方根(=1.249) に一致するよう成膜条件を調整した。



図21 CaF<sub>2</sub>基板両面に単層反射防止膜を形成したサンプルの分光透過率測定結果 (オートクレーブ処理温度:130℃, 基板:CaF<sub>2</sub>( $\phi$  30mm, 厚み=3mm), 膜構成:単層, MgF<sub>2</sub>層の屈折 率:1.22 ( $\lambda$ =190nm), 膜厚:34 nm)

測定結果をみると、ArF レーザーよりさらに波長の短い F<sub>2</sub> レーザー の波長(157nm)においても、99%を超える高い透過率が得られている ことがわかる。超先端電子技術開発機構(ASET)の「F<sub>2</sub> レーザーリソ 技術の開発」プロジェクトで示された、光学薄膜の損失に対する一次 目標値(0.5%)<sup>[2]</sup>から算出される両面コート基板の透過率は 99%であ るが、本サンプルの 157nm における透過率はこの目標値を上回ってい た。これは、単に狙い通りの屈折率が実現されていたということだけ でなく、本手法で作製した膜の吸収損失が極めて小さいことを示して いる。真空紫外領域では、物質の構造欠陥や不純物により吸収係数が 大きくなりやすいことから、低吸収であることは実用化する上で重要 なポイントとなる。 3-2 多層反射防止膜の作製と特性評価

次いで、反射防止膜を多層化した際に、設計通りの特性が得られる ことを、実際にサンプルを作製して角度反射特性を測定することによ り確認した。以下にその結果を示す。

3-2-1 シミュレーション

実験にあたり、まず作製する反射防止膜の設計を行った。基板は真 空紫外用光学系によく用いられる合成石英ガラスとし、対象波長λは ArF レーザーの波長である 193nm とした。層数は図 7 で示した反射防 止膜と同じ 5 層とし、最上層には屈折率 1.18 の MgF<sub>2</sub>超低屈折率層を 配して、入射角 0°からできるだけ大きな入射角まで、なるべく反射 が 0%となるように各層の厚さを調整した。得られた設計解の角度特性 を図 22-(a)に示す<sup>[3]</sup>。本反射防止膜は最上層に超低屈折率層を有する ため、NA=0.85 の投影レンズにおける θ<sub>max</sub> である 58°においても、 0.5%という低い反射率が得られている。緻密な MgF<sub>2</sub>層を最上層に配し た場合、膜厚の最適化を行っても 58°での反射率は 2%を超えることか ら、超低屈折率層の導入は反射防止膜の角度特性改善にきわめて効果 的であると言える。

3-2-2 成膜と反射防止特性の確認

上記設計解を基に、実際に合成石英ガラス基板上に反射防止膜を形成し、分光光度計を用いて角度特性の測定を行った。成膜にあたり、 下地4層は真空蒸着で形成し、最上層の超低屈折率層のみを本研究に よるゾルーゲル法で形成した。図 22-(b)に 193nm における角度特性の 測定結果を示す<sup>[3]</sup>。測定を行った全入射角度範囲において、実測値(b) は設計値(a)に近く、ほぼ設計通りの角度特性が得られていることがわ かる。また、設計値と同様に実測反射率も入射角 62° まで 1%以下であ り、58° での残存反射は 0.6%であった。先に述べたように、58° は NA = 0.85 の投影レンズの θ<sub>max</sub>であることから、本コートは NA=0.85 の 投影レンズに適用可能な十分な角度特性を備えていると言える。



図 22 5 層反射防止膜の角度特性評価結果((a) 設計値,(b) 実測値, 基板:合成石英ガラス, 膜構成:5層, λ=193nm, 最上層屈折率:1.18)

## 3-3 レーザー耐久性の評価

3-1-2 項で、本技術を用いて作製した超低屈折率膜は吸収損失が小 さいことを報告したが、低吸収損失は高い透過率を得るために有利で あるばかりでなく、高レーザー耐久性を実現する上でも有利である。 また、投影レンズを含む半導体露光装置に使用される光学系において は、硝材だけでなく光学薄膜にも高いレーザー耐久性が要求される。 そこで、本研究では MgF<sub>2</sub>ナノ粒子膜を用いて単層反射防止膜サンプル を作製し、ArF レーザーの繰り返し照射による耐久性評価を行った。 実験は、片面に単層反射防止膜を形成した合成石英ガラスサンプルの 表面に ArF レーザーを繰り返し照射し、一定回数照射した後にサンプ ルを取り出して、膜の破壊の有無を光学顕微鏡で観察した。光学顕微 鏡による照射前後の膜面比較観察で、照射前には無かった欠陥像が膜 面に観察された場合、ダメージありと判定した。表2に評価結果を示 す<sup>[1]</sup>。

照射パルス数	5.0E6	1.0E7	2.0E7	3.0E7	4.0E7	5.0E7
700 mJ/cm <sup>2</sup> /pulse	OK	NG	NG	NG	NG	NG
600 mJ/cm <sup>2</sup> /pulse	OK	OK	OK	OK	OK	OK

表 2 ArF レーザー用単層膜サンプルのレーザー耐久性評価結果

NG: 光学顕微鏡による観察でダメージを発見 OK: 光学顕微鏡による観察でダメージの発生無し

サンプル:片面コート合成石英ガラス
 膜構成:単層
 レーザー波長:193nm (ArF)
 レーザー周波数:1 kHz

700mJ/cm<sup>2</sup>/pulse のエネルギー密度では、5.0E6 ショット照射後に膜面 に小さなダメージが認められたが、600mJ/cm<sup>2</sup>/pulse のエネルギー密度 では、5×10<sup>7</sup> ショットの照射の後でも膜の破壊は認められなかった。 これは投影レンズの実使用条件に比べてかなり高いエネルギー密度で あり、投影レンズに適用する反射防止膜としては十分高いレーザー耐 久性を有しているといえる。上記結果より、本手法で形成した超低屈 折率層は、反射防止性能が優れているだけでなく、優れたレーザー耐 久性も有していることが確認された。

## 3-4 膜厚均一性の評価

光学薄膜においては、一般に有効径内全体で均一な光学特性を有す ることが求められる。ところが、レンズのように曲率を有する基板に 形成される光学薄膜では、しばしば中心部と周辺部の光学特性が異な るという問題が発生する。これは、光学薄膜の主たる成膜法であるド ライプロセスにおいて、膜材料の供給源と光学基板各部との距離の相 違により膜物質の供給密度が変わってしまうことによる。そこで、ド ライプロセスの成膜装置では、膜材料の供給源と光学基板との位置関 係を調整したり、光学基板を自公転させたりすることにより、できる だけ均一な成膜が可能となるよう工夫されている<sup>[4]</sup>。

そこで本研究では、ウェットプロセスにおける代表的な成膜法であ るスピンコート法<sup>[5]</sup>により、直径 300mm の石英ガラスウェハーに MgF<sub>2</sub> ナノ粒子膜の成膜を行い、ウェハーの中心,中間および辺縁部の分光 特性を比較した。さらに、スピンコート法では、基板の直径に応じて 滴下した液にかかる遠心力が変わるため、同じ塗布液を用いても基板 サイズにより膜厚が変わってしまう可能性がある。そのため、大きさ の異なる 3 種の基板に同じゾルを用いて成膜を行い、得られた膜の分 光透過特性を比較することにより膜厚の違いを評価した。

3-4-1 サンプル作製法

膜厚の面内均一性評価の評価には、裏面に割断用の溝を形成した石 英ガラスウェハーを用いた。図 23 にサンプル作製法の概念図を示す<sup>[6]</sup>。

基板裏面には、予め 30mm 間隔でダイヤモンドカッターを用いて割断 用の溝を形成した。溝を裏面に形成するのは、成膜時にゾルの広がり を妨げないようにするためである。また、基板サイズは想定される最 大の光学基板サイズを考慮し、φ 300mm (12in)とした。溝を形成した 300mm 石英ガラスウェハーの写真を図 24 に示す。溝で区切られた各ブ ロックには、割断後に区別できるよう個別に番号を振り、測定時の基 板部位の識別に用いた。

成膜はスピンコート法により、回転数 1000rpm にて行った。成膜後 のサンプルはオーブンを用いて 150℃で 1 時間加熱し、十分乾燥させ た後、膜面に触れないよう個々のブロック(69枚)に割断した。ウェ ハーはそのままでは分光光度計に入らないが、割断することによりサ ンプル室にセットすることができるようになり、高精度な分光透過率 測定が可能となった。

基板サイズの影響評価については、φ30mm,200mm(8in)および 300mm(12in)の合成石英ガラス基板に同じゾルを用いて単層膜を形成 し、200mm および 300mm 基板については面内膜厚均一性評価と同様の 方法で割断し、分光透過率を測定することにより基板サイズの違いに よる膜厚の比較を行った。



図 23 膜厚均一性評価用サンプルの作製法



図 24 膜厚均一性評価用石英ガラスウェハーの外観写真(成膜前)

3-4-2 測定方法

得られたサンプルの分光透過率は、分光光度計を用いて測定した。 面内膜厚均一性評価では、図 25 に示す a (中心部), b (中間部) およ び c (辺縁部)の9点について分光透過率の測定を行い、部位ごとお よび部位間の分光透過率を測定することで、膜厚の比較を行った。基 板サイズの影響評価では、200mm および 300mm 基板については、面内 膜厚均一性評価と同様の方法で成膜後に基板を割断し、中心部の分光 透過率を測定することで基板間の比較を行った。



図 25 膜厚均一性評価用サンプルの模式図 (a:中心部, b:中間部, c:辺縁部)

図 26 に各部位の測定結果を示す。中間部 b と辺縁部 c については、そ れぞれ 4 ヶ所の分光透過プロファイルを重ね書きしているが、いずれ もよく一致しており、同心円方向の膜厚・屈折率が均一であることが わかる。また、中心部 a, 中間部 b および辺縁部 c の差について注目 すると、各部位の透過プロファイルはよく一致しており、放射方向



図 26 φ 300mm 基板上に成膜した単層膜の膜厚分布評価結果 ((substrate) 未成膜基板,(a) 中心部,(b) 中間部,(c) 辺 縁部))

についても均一な膜厚・屈折率の膜が形成されていることがわかる。 これは、曲率を持った基板についても同様であり、特に半球に近い大 きな曲率を持つ基板への均一性膜が可能である点が、蒸着やスパッタ といった従来の成膜プロセスに対する本手法の大きなアドバンテージ の一つとなっている。

図 27 には、異なる大きさの基板に成膜した単層膜の分光透過率測定 結果を示す。全ての分光透過プロファイルがほぼ重なっていることか らわかるように、基板サイズが異なっても、得られる膜の膜厚には影 響が見られなかった。これは、真空蒸着などと同じように、テストピ ースで大型基板上に形成された膜の特性保証ができることを示してお り、本技術を実用化する際に現品測定を行わなくて済むのは、大きな メリットであると考えられる。



図 27 大きさの異なる基板に成膜した単層膜の透過率比較

以上に示したような優れた面内均一性や膜厚の基板サイズへの非依 存性は、本手法で得られるゾルの粘度が極めて低いことが理由の一つ であると考えられる。本手法で得られるゾルの粘度は、アルコールの それよりわずかに高い程度であり、いわゆる液の"レベリング"が非 常に良い。塗布液のレベリングが良いと、スピンコート中に辺縁部の 液が飛び散った際に、速やかに中間部・中心部より液が供給され、面 内の液膜の厚さが均一に保たれることになる。膜厚の基板サイズへの 非依存性も、液が流動しやすいこと、および、液膜が薄くなるとゲル 化により急激に粘度が上昇し、液膜が固定されることによりもたらさ れる性質であると考えられる。 3-5 結論

以上述べたように、オートクレーブ処理を行ったゾルを用いて形成 した MgF<sub>2</sub>ナノ粒子膜は、真空紫外領域においても 1.30 以下の超低屈 折率を有しており、同じゾルから濃度を変えて成膜したナノ粒子膜は、 膜厚によらず同じ屈折率を有していた。CaF<sub>2</sub> 両面に単層膜を形成した サンプルでは、真空紫外領域においても 99%を超える高い透過率を示 した。また、MgF<sub>2</sub>ナノ粒子膜を最上層に配した 5 層反射防止膜では、 設計通りの角度特性が得られ、入射角 58°における反射率は 0.6%と従 来反射防止膜の約 1/3 の値であった。ArF レーザーの連続照射による レーザー耐久性の評価では、半導体露光装置の投影レンズに十分使用 可能な高い耐久性を示した。さらに、面内膜厚均一性の評価では、 φ 300mm 基板上でも均一な膜が形成されていることが確認され、基板の サイズがほとんど膜厚に影響を及ぼさないことも確認された。

これらの MgF<sub>2</sub>ナノ粒子膜の特徴的な性質の多くは、オートクレーブ 処理によりもたらされたと言える。オートクレーブ処理がゾル、ナノ 粒子および膜に及ぼす影響をまとめると、図 28 のようになる。オート クレーブ処理は、酢酸とメタノールの反応により酢酸メチルを形成す ることでゾルの粘度を低下させ、MgF<sub>2</sub>粒子の結晶化と、一次粒子,二 次粒子の成長を促進する。その結果、ゾルの濃縮可能濃度が高くなる ことにより、一度の成膜で実現可能な膜厚範囲が広がり、得られる膜 の屈折率範囲も、より低屈折率側に広くなる。その結果、1.41~1.17 (λ=193nm)というこれまでに報告のないほど広い屈折率範囲で、任 意の屈折率を有する膜が作製可能となった。

以上のような優れた特性により、本手法で作製した MgF<sub>2</sub>ナノ粒子膜 を用いた反射防止膜は、最新の ArF 半導体露光装置の投影レンズに採 用された。半導体露光装置の光学系にウェットプロセスにより形成さ れた光学薄膜が適用されたのは、本研究により得られた MgF<sub>2</sub>ナノ粒子 膜が世界初である。また、1.30 以下の超屈折率を有する光学薄膜が、 ある程度量産される工業製品に搭載された例としても、おそらく世界 で初めての例であると考えられる。



図 28 オートクレーブ処理がゾル, MgF<sub>2</sub>粒子および得られる多孔 質膜に及ぼす影響 [1] T. Murata, H. Ishizawa, I. Motoyama and A. Tanaka, Appl. Opt.,45, 1465-1468 (2006).

[2] 新エネルギー・産業技術総合開発機構,"「F<sub>2</sub>レーザーリソ技術の 開発」研究成果報告書", p.179 (2002).

[3] 村田剛, 光学, 40, 17-23 (2011).

[4] 李正中,"光学薄膜と成膜技術",アグネ技術センター, pp.341-364 (2002)

[5] 高橋康隆 他, "ゾル-ゲル法による薄膜コーティング技術", 技術情報協会, pp.3-4 (1996).

[6] T. Murata, H. Ishizawa, I. Motoyama and A. Tanaka, Appl. Opt.,47, 246-250 (2008).

第4章

# 可視光用反射防止膜の作製

第3章で紹介したような優れた特性を有することから、本研究で作 製した MgF<sub>2</sub>ナノ粒子膜を用いた反射防止膜は、最新の ArF 半導体露光 装置の投影レンズに採用となった。そこで、紫外光用反射防止膜に次 いで、本研究では可視光用反射防止膜にも MgF<sub>2</sub>ナノ粒子膜を適用する ための検討を開始した。先に述べた屈折率分散により、反射防止の対 象が紫外光からより波長の長い可視光になれば、膜の屈折率はさらに 低くなることから、より高い反射防止効果が得られることが期待され た。

従来、写真撮影用レンズ、特に広角レンズのように光線入射角が大 きなレンズにおいて、反射防止膜の角度特性の不足により抑えられな いゴーストが存在することが問題視されていた。また、ドライプロセ スによる成膜の問題として、曲率の大きなレンズに光学薄膜を形成し た場合、レンズ周辺部で膜厚が薄くなってしまうという問題もあった。

さらに近年、写真の露光媒体が銀塩フィルムから撮像素子へと変わることにより、カメラボディー内のローパスフィルター表面や撮像素子から強い反射・回折光が発生し、これまでは観察されなかったゴー ストやフレアーが発生することが問題になり始めていた(図 29)。

表3に、市販の銀塩およびデジタルカメラのローパスフィルター、 撮像素子について、反射率および後方散乱を測定した結果を示す。フ ィルムでは反射率が小さく後方散乱が大きいのに対し、ローパスフィ

ルターでは反射率が高いことがわかる。また、撮像素子で後方散乱が 大きいのは、画素の規則配列に起因する回折光が影響しているものと 考えられる。

ナノ粒子膜の超低屈折率は、可視領域においても反射防止膜の低反 射化,広入射角化に有効であると考えられ、さらに、曲率の大きなレ ンズ上での膜厚の面内均一性は、ドライプロセスによる光学薄膜の均 一性よりもはるかに優れているため、これらの問題を解決する上でき わめて強力な手段となると考えられた。



(a) レンズ間での反射

(b) レンズとフィルムあるいは撮像素子ユニット間での反射

図 29 フィルムー眼レフおよびデジタルー眼レフの構造と迷光 発生のしくみ
フィルム		ローパスフィルター		撮像素子	
平均反射率 400-700nm	後方散乱 400-650nm	平均反射率 400-700nm	平均反射率 430-660nm	平均反射率 400-700nm	後方散乱 400-650nm
2-4%	10-20%	5-16%	1-3%	0.3-0.4%	4-12%

表 3 フィルム, ローパスフィルターおよび撮像素子の反射率および 後方散乱



正反射

後方散乱

4-1 成膜プロセスの変更

上記の結果をうけ、本研究では MgF<sub>2</sub>ナノ粒子膜をカメラレンズ用反 射防止膜として利用するための技術開発を開始した。そして、これま での MgF<sub>2</sub>ナノ粒子膜作製工程に、より工程適用性を改善するために膜 強度改善のためのバインダー添加工程を加え、可視光用反射防止膜の 作製に適したプロセスを確立した。図 30 に可視用ナノ粒子膜の作製プ ロセスを示す。



図 30 可視用 SiO<sub>2</sub>バインダー添加 MgF<sub>2</sub>ナノ粒子膜の成膜手順

本プロセスにおいて、オルトケイ酸テトラエチル(tetraethyl orthosilicate: TEOS) は酸を触媒として、加水分解反応(i)と脱水縮 合反応(ii)により、図 31 に示したような構造変化が生じて硬化し、バ インダーとして膜強度を向上することが期待された。

$$nSi(0C_{2}H_{5})_{4} + nH_{2}O \rightarrow nSi(0H)(0C_{2}H_{5})_{3} + nC_{2}H_{5}OH$$
(i)

$$\operatorname{Si}(\operatorname{OH})_4 + \operatorname{Si}(\operatorname{OH})_4 \rightarrow (\operatorname{OH})_3 \operatorname{Si} - \operatorname{O} - \operatorname{Si}(\operatorname{OH})_3 + \operatorname{H}_2 \operatorname{O}$$
 (ii)



図 31 酸触媒を用いた TEOS の加水分解、脱水縮合による Si-0 ネットワーク形成の模式図

図 30 に示したプロセスを用いて得られた、石英ガラス基板上のナノ 粒子膜の SEM 像を図 32 に示す。外観は紫外用光学薄膜とほとんど変わ らず、二次粒子が空隙を残して基板上に堆積している点についても同 様であった。本結果より、添加したバインダーは粒子間の空隙を埋め ることなく膜中に存在していることがわかる。また、膜の深さ方向に ついても、バインダーが偏在している様子は認められなかった。これ は、反射率,透過率測定からシミュレーションにより求めた、膜の屈 折率勾配がない(不均質無し)という結果とも一致した。



図 32 SiO<sub>2</sub> バインダー添加 MgF<sub>2</sub>ナノ粒子膜の断面 SEM 像 (AC 処理温度:140℃, 膜構成:単層)

次いで、バインダー添加の効果を確認するため、膜の硬度試験を行った。測定はマイクロインデンテーション装置(NEC 三栄(株) 薄膜物 性評価装置 MH4000)を用い、同じゾル原液より調製したバインダー無 添加サンプルと添加サンプルについて行った。測定には三角錐ダイヤ モンド圧子を用い、圧子を試料に押込んだ後、押込み過重と押込深さ からビッカース硬度換算値を求めた。図 33 に測定結果を示す。バイン ダー無添加の MgF<sub>2</sub>ナノ粒子膜の硬度は 20MPa であったのに対し、バイ ンダーを添加した MgF<sub>2</sub>ナノ粒子膜の硬度は 133MPa であり、バインダ ー添加により硬度はおよそ 6 倍に向上していた。次いで、光学製品用 の織布ワイパーにメタノールを浸し、両サンプルを拭いたところ、バ インダー無添加サンプルでは容易に傷が入ったのに対し、バインダー



図 33 SiO<sub>2</sub> バインダー添加による膜強度向上効果(AC 処理温度:140℃, 膜構成:単層, 基板:BK7, MgF<sub>2</sub>:バインダー無し, MgF<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>:バインダー添加)

添加サンプルでは目視で確認できる傷は発生せず、硬度が向上したことにより耐擦傷性も向上していることが確認された。

以上の結果より、添加されたバインダーは図 34 に示したように、少 なくとも相接する MgF<sub>2</sub>粒子の接点部分に存在し、ネックを形成するこ とにより膜の強度を向上しているものと思われる。また、本評価で作 製したバインダー添加サンプルの MgF<sub>2</sub>ナノ粒子膜の屈折率は 1.26 で あり、バインダー添加後も多くの空隙がバインダーにより満たされる ことなく残存していることが確認された。バインダー添加量を増やせ ば膜強度をさらに向上させることは可能であるが、空隙がバインダー で満たされることにより膜の屈折率が上昇し、光学的メリットが減少 してしまう。種々の実験の結果から、膜強度と屈折率のバランスを考 慮すると、1.20~1.30 程度の屈折率が実用化する上で適当であること



図 34 SiO<sub>2</sub> バインダー添加 MgF<sub>2</sub>ナノ粒子膜の構造概念図

が明らかとなった。したがって、以降の実験では主に屈折率が 1.26 と なるようバインダー添加量を固定し、各種サンプルを作製した。 4-2 単層反射防止膜の成膜と特性評価

ナノ粒子膜にバインダーを添加しても、不均質の無い膜が形成可能 であるとの結果を受け、可視用単層反射防止膜の作製を行った。単に 単層反射防止膜を形成するだけであれば、従来技術でも容易に形成可 能であるが、本技術の特徴として"屈折率が任意に設定可能"である という性質があることから、550nmで反射率が0%となる反射防止膜の 形成を試みた。

光学基板上に形成した単層反射防止膜の反射率は、式(3)で表わされる<sup>[1]</sup>。

$$R = (n_1^2 - n_0 n)^2 / (n_1^2 + n_0 n)^2$$
(3)

ここで、*R*はサンプル表面の反射率, *n*<sub>0</sub>は媒質の屈折率, *n*<sub>1</sub>は膜の屈 折率, *n*は基板の屈折率である(図 35)。



図 35 単層反射防止膜の模式図

式(3)からわかる通り、媒質が空気  $(n_o=1)$  の場合、反射率 R が 0 となるのは式(1)の分子が0になる、すなわち $n_1^2 = n$ となる場合だけで ある。つまり、膜の屈折率 n<sub>1</sub>の平方根が基板の屈折率 n に一致しなく てはならない。一般的な光学ガラスの屈折率は、およそ 1.45 から 2.0 位まで(λ=550nm)であるから、単層膜で反射率 0%を得るには、膜 の屈折率を 1.20 から 1.41 位までに設定する必要がある。ところが、 一般的に用いられる膜物質の屈折率で最も低いのは、MgF,の 1.39 であ り、0%反射を実現しようとする場合、屈折率 1.90 程度のガラスまでし か対応できない。一方、先にも述べた通り、本研究にて開発した MgF。 ナノ粒子膜は広い範囲で屈折率が可変であり、バインダー添加を行っ ても実現可能な屈折率範囲の低屈折率側がわずかに狭まるだけである。 したがって、現存する全ての光学ガラスで、狙った波長において反射 率0%を有する単層反射防止膜が形成可能なはずである。そこで、本研 究では屈折率 1.75 の光学ガラスを基板として選択し、その上に屈折率 が 1.32 となる単層反射防止膜を形成した。膜厚はλ=550nm で最も低 い反射率が得られるよう調整した。得られたサンプルの分光反射特性 の測定結果を図 36 に示す<sup>[2]</sup>。本図からわかる通り、550nm 付近でほぼ 0%の反射率が得られていた。このことより、本サンプルでは単に必要 な膜厚が実現されているだけでなく、狙い通りの膜の屈折率が実現さ れていることがわかる。このように、膜厚だけでなく任意の屈折率が 実現可能であるという特徴は、本プロセスの大きなアドバンテージと なっている。ドライプロセスでは、同じ膜物質を用いて本プロセスの ように広い範囲で屈折率が変更可能な手法はなく、ウェットプロセス ならではの特徴であると言える。このような特徴は、大きな曲率を有

する半球レンズのような光学基板に単層膜を形成する際に、特に有用 である。本手法を用いれば、曲率のきついレンズ面に、従来よりも反 射防止性能の優れた単層反射防止膜を、均一に成膜することが可能で ある。



図 36 単層膜の分光反射特性測定結果

4-3 多層反射防止膜の成膜と特性評価

4-3-1 シミュレーション

以上説明したように、単層膜で良好な反射防止特性が得られたこと から、次に多層膜の作製も試みた。まず、成膜に先立ち、可視光用反 射防止膜においてどの程度の性能改善が可能であるか、シミュレーシ ョンにより検討することとした。先に述べた紫外光用反射防止膜では、 光源が単色光であるレーザーであったため、波長帯域については考慮 する必要がなかったが、可視光用反射防止膜、特に写真レンズ用反射 防止膜では、広い波長範囲にわたって反射防止を行う必要があるのが 大きく異なる点である。シミュレーションに用いる反射防止膜の設計 にあたっては、直入射でできるだけ低い反射率が帯域内で均等に得ら れるように配慮し、その上で光線が斜め入射になった場合でも、赤色 光の反射がなるべく高くならないように工夫した。赤色光に着目した のは、一般的な撮影では特に赤いゴーストが目につき、問題となるこ とが多いからである。図 37 に、シミュレーションにより得られた、最 上層の屈折率が異なる4種類の7層可視光用反射防止膜の分光反射特 性を示す。角度特性も比較できるよう、シミュレーションは各設計解 について、入射角 0°, 45° および 60° での分光反射特性を計算し、 同じグラフ上に重ね書きした。本結果をみると、最上層の屈折率が低 いほど直入射での帯域内での反射率が低く、いずれの入射角において もより低い反射率が得られることがわかる。また、最上層の屈折率が 低いほど、広い反射防止帯域が得られた。これらの結果より、可視光 用反射防止膜に超低屈折率層を導入することで、主に、

- 1) 広帯域化
- 2) 低反射率化
- 3) 広入射角化

といったメリットが得られることが予想された。帯域については、あ る程度広ければそれ以上は必要ないが、先にも述べた通り、低反射化 と広入射角化は写真のデジタル化において非常に大きなメリットにな る。



図 37 最上層の屈折率が異なる可視光用反射防止膜のシミュレ ーションによる特性比較(膜構成:7 層、基板屈折率:1.52 (λ =550nm),最上層の屈折率:(a)1.39,(b)1.30,(c)1.25,(d)1.20 (いずれもλ=550nm),光線入射角:0°,45°,60°)

4-3-2 成膜と反射防止特性の確認

以上説明した通り、可視用反射防止膜に超低屈折率層を導入した場 合、大きなメリットが得られることがシミュレーション結果より期待 されたことから、実際に反射防止膜を作製し、期待通りの反射防止効 果が得られるかどうか検証を行った。試作は屈折率 1.26 の超低屈折率 層を最上層に配した9層反射防止膜について行い、下地8層をマグネ トロンスパッタリングにて形成した後、最上層を本研究にて開発した ゾル−ゲル法により形成した。得られた9層反射防止膜の分光反射特性 の実測値を、設計値と合わせて図 38 に示す<sup>[2]</sup>。通常、反射防止膜の特 性は縦軸フルスケール 2~5%で表現することが多いが、本反射防止膜 の場合はボトム部分の反射率が極めて低いため、差異がわかりやすい ようフルスケールを1%とした。本反射防止膜を設計するにあたり、層 数を 10 層以下に抑えつつ、主に 0°入射における残存反射をできるだ け低く抑えることに主眼を置いて設計したが、得られた反射防止膜の 分光反射率をみてみると、設計値同様、ほぼ可視全域で非常に低い反 射率が得られていることがわかる。波長 650~450nm の範囲で平均反射 率を計算してみると、0.0098%という極めて低い値であった。これは、 従来の一般的なカメラレンズ用反射防止膜のおよそ 1/10 以下という、 極めて低い反射率である。最近では、10層を超える膜構成の反射防止 膜も市販の交換レンズに適用されている例があるが、これほど低い反 射率が得られる反射防止膜は存在しない。また、設計値との差異をみ ると、実測値の帯域は若干設計値より低いものの、全体のプロファイ ルとしては設計値とほぼ一致していた。



図 38 MgF<sub>2</sub>ナノ粒子層を最上層に有する可視光用反射防止膜の 反射率測定結果(基板屈折率:1.59(λ=550nm), 膜構成:9層, 最上層屈折率:1.26(λ=550nm), 入射角:0°, Ra 平均反射率)

4-4 実用化

4-4-1 ゴースト・フレアー防止効果の確認

次いで、本技術導入による反射防止性能の改善効果を視覚的に確認 するため、平面ガラス基板を用いてコート性能比較用のサンプルを作 製し、反射防止膜無しのサンプルおよび従来技術(真空蒸着)で反射 防止膜を形成したサンプルとの外観比較を行った。図 39 にサンプル鏡 筒断面の模式図(図 39-(A))と、各サンプルを斜めからの照明光で撮 影した写真(図 39-(B))を示す。本サンプルには平行平板の光学ガラ ス基板を14枚用い、反射防止膜未形成品(a),従来反射防止膜(7層) 形成品(b)およびナノ粒子反射防止膜(5層)形成品(c)の3種を作製 した。基板14枚という構成枚数は、一般的なズームレンズのレンズ構 成枚数とほぼ同じ数である。反射防止膜以外、各サンプルの仕様は同 ーとし、各サンプル底面にはデジタルカメラを模して撮像素子を配置



図 39 平面ガラスを用いたコート性能比較サンプル((A) サン プル鏡筒断面模式図,(B) サンプル鏡筒外観写真,構成:ガラス 基板 14 枚,基板屈折率:1.52(λ=550nm),(a) 反射防止膜無し, (b) 従来反射防止膜,(c) ナノ粒子反射防止膜)

した。撮影された写真を見ると、反射防止膜の無いサンプル(a)はもち ろんであるが、従来反射防止膜を形成したサンプル(b)においても、ガ ラス基板表面の反射が高く、奥に配置された撮像素子が見えにくくな っていることがわかる。一方、本技術を用いて最上層に屈折率1.26の 超低屈折率層を有する反射防止膜を施したサンプル(c)では、従来反射 防止膜品に比べて膜の構成層数が少ないにもかかわらず、斜入射の照 明下でも低い反射率を保っており、サンプル底部に配置した撮像素子 を明瞭に観察することができた。これは本技術を導入した反射防止膜 が、優れた角度特性を有することを示す結果であるといえる。本サン プルの基板構成は14枚であったが、構成枚数が多くなれば、その外観 の違いはさらに大きくなると考えられる。

さらに、本技術によるゴースト・フレアーの低減効果を実際の撮影 像で確認するため、一眼レフカメラ用広角ズームレンズの適用可能な 面全てに、本技術を用いた反射防止膜を形成した試作レンズを作製し、 全く同じレンズ構成で通常の反射防止膜を有する従来レンズとの撮影 比較を行った。ゴースト,フレアーの発生の仕方は絞り値により変わ るため、比較はF11とF22の2条件で行い、撮影はAPS-Cサイズの撮 像素子(DXフォーマット)を有するデジタル一眼レフカメラを用いて 行った。図40,41に、同じ撮影条件で両レンズにより撮影された画像 を示す。比較は通常の可視光で撮影された画像(図40)の他に、赤外撮 影用フィルターを装着して撮影した画像(図41)でも行った。可視光で の撮影比較では(図40)、両レンズの反射防止性能の違いは明らかで、 試作レンズで撮影した画像(a-1),(a-2)に写るゴーストは、従来レン ズで撮影した画像(b-1),(b-2)のものに比べて著しく少なく、さらに

画像のシャドー部の濃度が増し、コントラストも向上していることが わかる。これは、ゴーストだけでなくフレアーも減少したことを示し ている。本撮影は APS-C サイズの撮像素子で行ったが、ゴーストは画 面周辺部で強く出る傾向があるため、より大きなフルサイズの素子を 用いて撮影を行っていれば、さらに大きな違いが出たものと考えられ る。

さらに、反射防止性能改善の効果は、赤外撮影においても確認でき た(図 41)。比較のために、両レンズで同じ被写体を可視光と赤外光 で撮影した2種類の画像を並べて示すが、試作レンズで撮影された画 像では、可視光で撮影した場合(a-1)はもとより、赤外光で撮影した 場合(a-2)においても、目立つゴーストはほとんど発生しなかった。 これに対し従来レンズでは、可視光での撮影時に、太陽に対し画面反 対側隅に目立つゴーストが発生しただけでなく(b-1)、赤外光での撮影 時には、太陽近傍から画面の対角線に沿って、さらに広い範囲で目立 つゴーストが多数発生した(b-2)。実験に使用した試作レンズに形成 した反射防止膜は、特に赤外領域での反射防止を考慮して設計された ものではないが、超低屈折率層を導入したことによる反射防止帯域の 拡大効果が、このような結果につながったものと考えられる。本実験 により、カメラレンズ用反射防止膜への超低屈折率層の導入で、きわ めて広い波長帯域で撮影画像の画質改善が可能であることが確認でき た。

以上の結果より、カメラレンズ用反射防止膜に超低屈折率層を導入 することで、その性能を飛躍的に改善することが可能であり、撮影画 像の画質も大きく改善されることが確認された。このことから、超低

屈折率層を有する高性能反射防止膜をデジタルー眼レフカメラ用交換 レンズに適用することは、カメラのユーザーにも大きなメリットをも たらすと考えられた。



図 40 広角ズームレンズを用いた反射防止膜の性能比較(撮影: 可視光, (a-1) 試作レンズ・F11 撮影, (a-2) 試作レンズ・F22 撮影, (b-1) 従来レンズ・F11 撮影, (b-2) 従来レンズ・F22 撮影)



図 41 ズームレンズを用いた反射防止膜の性能比較((a-1) 試 作レンズ・撮影:可視光,(a-2) 試作レンズ・撮影:赤外光,(b-1) 従来レンズ・撮影:可視光,(b-2) 従来レンズ・撮影:赤外光)

## 4-4-2 製品への適用

以上に紹介したような優れた反射防止効果により、本技術を用いて 形成した MgF<sub>2</sub>超低屈折率層を有する反射防止膜は「ナノクリスタルコ ート」と命名され、デジタルー眼レフカメラ用交換レンズへの搭載が 決定した。最初の適用製品である望遠レンズ「AF-S VR Nikkor ED 300mm F2.8G(IF)」は、2004 年にドイツのケルンで開催された世界最大の映 像関連製品の見本市「フォトキナ」で発表された。図 42 に、フォトキ ナで展示された当該レンズの画像を示す。そして、本レンズは 1.30 以 下の超低屈折率層を有する反射防止膜を搭載した、世界初のカメラレ ンズとして、翌 2005 年の1月に市場投入された。本レンズは望遠レン ズであるため、レンズを通過する光線の最大入射角はそれほど大きく ないが、撮像素子とレンズとの間で発生する多重反射がゴーストを発 生させる懸念があり、超低屈折率層導入効果の一つである低反射化に よりゴーストを低減する目的で、ナノクリスタルコートを適用した。

適用当初はナノクリスタルコートに関する情報が不足していたこと もあり、ユーザーの間では傷の付きにくい"硬いコート"ではないか といった誤った情報が流れた。光学薄膜の反射防止原理(光の干渉作 用)は一般のユーザーにはあまり理解されておらず、超低屈折率の実 現によりもたらされるメリットを理解するのは、なかなか難しかった ようである。しかし、雑誌媒体などを利用した技術情報の発信により 次第に正しく理解されるようになり、その優れた描写性が評判となっ て認知度も高まっていった。



図 42 初のナノクリスタルコート適用交換レンズ (AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR)

その後、ナノクリスタルコートは、2 機種目の製品として AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED に 2006 年 3 月に適用され、さらに 翌年 11 月には、AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED および AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED に適用された。3 機種目,4 機種目の適用製品であ る両ズームレンズは、一般撮影および報道で常用される焦点域をカバ ーする製品であり、これらの製品の市場投入により、ナノクリスタル コートはユーザーにとってより身近なものとなった。特に、AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED は超広角域を含む広角ズームレンズであり、 曲率のきついレンズ周辺部で発生する赤いゴーストが問題となる仕様 の製品であったが、ナノクリスタルコートの適用により、レンズ周辺 部まで均一な反射防止特性が実現でき、そのクリアな描写が特に話題 となった。

また、新規技術を適用する場合、良品率の低さや製造工程のトラブ ルにより製品計画の変更を余儀なくされることが多いが、ナノクリス タルコートの場合はその良好な生産性により、最初の製品からそのよ うなトラブルも発生しなかった。そして、5 機種目以降もナノクリス タルコートを搭載したレンズは順調に増え続け、後継モデルに置き換 わった製品も含めると、本原稿執筆時点で 20 機種となっている(図 43)。

競合技術としては、2008 年 12 月にキヤノンにより花弁状 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 結晶 を用いた傾斜屈折率層を有する「SWC」が、2009 年 2 月にはペンタッ クスにより SiO<sub>2</sub>ナノ粒子を用いた超低屈折率層を有する「エアロブラ イトコーティング」が実用化されたが、現在までの適用製品はいずれ

も数機種にとどまっており、ナノクリスタルコートほどの展開は見ら れない。また、いずれの技術もナノクリスタルコートと同じウェット プロセスであるが、膜物質として酸化物を用いており、真空紫外領域 では大きな吸収損失が発生し使用することはできず、可視領域での実 用化にとどまっている。



(株)ニコンの Web サイトより引用

図 43 ナノクリスタルコートを適用した一眼レフ用交換レンズ

## 4-4-3 適用製品分野の拡大

以上説明したように、ナノクリスタルコートはその優れた反射防止 特性から、多くのデジタルカメラ用交換レンズに適用された。しかし、 その導入効果はカメラ用交換レンズ以外の製品分野においても大きい と考えられることから、本研究ではニコンのもう一つの事業の柱であ る顕微鏡関連製品への適用検討を開始した。

顕微鏡の対物レンズ中には、曲率のきつい凸レンズが多く用いられ ており、従来、そのような面への均一性膜が困難であることが問題と なっていた。そこで、そのような面にナノクリスタルコートを形成し た試作品を作製し、従来反射防止膜を形成した通常品と比較したとこ ろ、対物レンズの透過率が向上し、顕微鏡での観察像のコントラスト が向上することが確認できた。顕微鏡の場合はカメラのレンズのよう に入射光の条件が大きく変化することはないが、観察像のコントラス トは、特に生物試料の観察において重要であることから、対物レンズ へのナノクリスタルコート適用が決定し、2009 年 11 月には、「CFI Apo



(株)ニコンの Web サイトより引用

図 44 ナノクリスタルコートを適用した顕微鏡用対物レンズ

40× WI λSJ,「CFI Apo 60× H λS」 および「CFI Plan Apo IR 60 × WI 」の3種の対物レンズに適用となった(図 44)。現在では、カ メラ用交換レンズと同様に、顕微鏡用対物レンズにおいても、ナノク リスタルコートによりもたらされる高い結像性能は、ユーザーの高い 評価を得ている。 4-5 結論

本研究では、半導体露光装置の投影レンズ用に開発した、1.30以 下の超低屈折率を有する MgF。ナノ粒子膜に対し、バインダーの添加に より膜強度を向上する工夫を加えて工程適用性を向上し、大規模量産 にも対応可能な成膜プロセスを確立した。バインダーを加えることで 膜の硬度を 6 倍以上に向上することが可能であり、膜面を光学ワイパ ーで拭くことが可能となった。バインダー添加により膜の屈折率は若 干高くなるが、それでも可視領域において 1.30 以下の屈折率を実現で きることが確認された。1.30以下の超低屈折率を維持したまま、手拭 きが可能な膜強度を実現できたことは、本技術を実用化する上で大き なアドバンテージとなった。また、ゾルの調製条件を変更することに より、任意に膜の屈折率を変更することが可能であった。この性質を 利用することにより、膜の屈折率を基板の屈折率の平方根に一致させ ることが可能となり、種々の屈折率を有する光学基板上に、特定波長 で反射率が0%となる反射防止膜を形成できることが確認された。これ は、これまでのドライプロセスにより形成された膜では実現できなか った性質であり、単色光に対する反射防止や、曲率のきつい基板の反 射防止を行う上で、きわめて有用な技術であるといえる。また、多層 反射防止膜の最上層に、本技術で形成した超低屈折率層を配すること により、媒質(空気)との屈折率差を小さくすることが可能となり、 反射防止波長範囲の広帯域化、帯域内での低反射率化、および反射防 止可能光線入射角の広入射角化が可能となった。さらに、実際に超低 屈折率層を導入した反射防止膜を、一眼レフカメラ用の交換レンズに

適用し、逆光などの厳しい条件下で撮影を行ったところ、従来反射防 止膜を形成したレンズに比べ、ゴーストだけでなくフレアーも減少し、 これまでにない"ヌケの良い"クリアな画像が得られることが確認さ れた。これらの優れた特徴により、本技術は 2005 年に「ナノクリスタ ルコート」としてデジタルカメラ用交換レンズ「AF-S VR Nikkor ED 300mm F2.8G(IF)」に搭載された。本レンズは、1.30 以下の超低屈折 率層を有する反射防止膜が適用された、世界初のカメラ用レンズであ る。その後、本技術の優れた生産性により、適用レンズは順調に増え、 現在までにモデルチェンジされた製品も含め、20 機種の製品に適用さ れている。さらに、適用製品はカメラ用交換レンズにとどまらず、顕 微鏡の対物レンズにまで拡大され、3 本の対物レンズに適用となって おり、顕微鏡による観察像のコントラスト向上に貢献している。 参考文献

[1] 小檜山光信, "光学薄膜の基礎理論 増補改訂版", オプトロニクス社, p.147(2011).

[2] T. Murata, H. Ishizawa, I. Motoyama and A. Tanaka, Appl. Opt.,45, 1465-1468 (2006).

## 第5章

## ナノ粒子膜の濡れ性制御

5-1 研究の背景

固体表面に存在する液体が広がったり、逆にはじかれたりする様子 は日常出会うことの多い物理現象である。このような、固体表面と液 体の接し方を"濡れ"と呼ぶ。身近な濡れ現象として、雨が降った際 に植物の葉が水滴をはじく様子をよく目にするが、このような水をは じく性質を撥水性(あるいは疎水性)と呼ぶ。特にハスの葉の持つ強 い撥水性は古くから注目されており、研究の対象となってきた(図 45-(a))<sup>[1]</sup>。ハスの葉は「lotus effect」と呼ばれる高い撥水性を有 し、その上に乗った水滴は葉をわずかに傾けただけで滑り落ちる。こ れは葉の表面に付着した汚れを除去するために、植物が進化の過程で 獲得した形質であると考えられ、サトイモなど他の多くの水生植物も 同様の性質を有している(図 45-(b))。一方、よく水をはじくにもか かわらず、水滴の付着力が高く、移動しにくい表面も知られている。 バラの花びらなどがその代表的な例であり、撥水性と高い付着力が両 立した状態は「花びら効果 (flower petal effect)」と呼ばれる (図 45-(c),(d))<sup>[2]</sup>。これら生物の撥水性は、単に水を弾く物質で覆われ ているだけでなく、微細な凹凸や毛で覆われていることにより発現し ている。

一方、濡れ性の制御は我々の生活においても有益であるため、傘や



図 45 ハスの葉, サトイモの葉およびバラの花びらの SEM 像 ((a) ハスの葉表面(Nelumbo Nucifera), (b) サトイモの葉 表面 (Colocasia Esculenta), (c),(d) バラの花びら表面)

レインコート,カーワックスといった様々な製品分野で、以前より利 用されてきた。ところが近年、濡れ性制御に対する要求性能の高まり と環境問題などにより、より高い性能と低エネルギーのプロセスを両 立するために、生物のもつ様々な機能から知見を得ようとする研究分 野が注目されるようになってきた。このような生体機能に関わる現象 を分析し、人工的に再現・利用しようとする研究分野を、生体模倣工 学(biomimetics:バイオミメティクス)と呼ぶ。バイオミメティクス における研究例としては、撥水の他、蛾の目を模した反射防止構造<sup>[3]</sup>, サメの表皮を模した低抵抗表面<sup>[4]</sup>,カタツムリの殻を模した防汚表面 <sup>[5]</sup>などが知られている。濡れに関しては、特に高い撥水性を得るための研究が盛んで、化学組成と微細構造を組み合わせることで、多くの 撥水表面を実現した例が報告されている<sup>[6-10]</sup>。

濡れは、液体が接していた空気がその他の固体に置き換わる現象で あり、濡れの進行に伴って固体/気体界面が消失し、新たに固体/液体 界面が形成され、表面自由エネルギーの変化が生じる。この表面自由 エネルギーの変化が濡れ性の尺度となるが、濡れ性を定量的に評価す る手段として接触角の測定が広く用いられている。接触角とは、固体 と液体が接触する境界面と、固体/液体境界線における液体表面に対す る接線が成す角であり、液体が存在する側の角度が用いられる(図46)。 図中、液滴は平滑で均質な固体表面に乗っており、θ が液体の接触角 である。接触角が大きいほど固体表面は液体をはじきやすく、撥水性 が高いといえる。逆に、接触角が小さいほど液体と固体表面のなじみ が良く、親水性であるといえる。



図 46 濡れにおける表面張力,界面張力と接触角の関係

平滑で均質な表面の濡れ性は、固体および液体の表面張力(表面自 由エネルギー)と固体/液体間の界面張力(界面自由エネルギー)のバ ランスで決まり、Youngの式により以下のように示される<sup>[11]</sup>。

$$\gamma_S = \gamma_{SL} + \gamma_L \cdot \cos \theta \tag{4}$$

ここで、y<sub>s</sub>, y<sub>L</sub>はそれぞれ、固体,液体の表面張力、y<sub>sL</sub>は固体/液体の 界面張力である。

表面張力は、液体を単位長さだけ広げるのに要する力であり、表面 を単位面積だけ広げるのに要する表面自由エネルギー(J/m<sup>2</sup>)と同一 である。ベクトル量であるため、大きさと方向を持ち、その単位は N/m である。

固体の表面張力 γsが大きく、固/液の界面張力 γsLが小さいと、液滴 は γsに引っ張られ、平らになって小さな接触角を示し、よく濡れた状 態となる。逆の場合には、液体は盛り上がって大きな接触角を示し、 はじいた状態となる。ヤングの式を支配しているのは表面張力と界面 張力であり、それらは物質に固有の物理量である。すなわち、濡れを 支配しているのは固体および液体の組合せであり、濡れにおけるこの ような因子を化学的因子と呼ぶ。

化学的因子を用いて撥水性を得ようとする時、しばしばフッ素系の 物質が用いられるが、それはフッ素系の材料が低い表面張力を有する ためである。フッ素原子は原子番号のわりに原子半径が小さいため、 外部電場に対して電子雲は揺らぎにくい。その結果、分極率が小さく なり、分子間の Van der Waals 力、すなわち凝集力が小さくなる。小

さな凝集力は当然小さな表面張力を与えるが、なかでも CF<sub>3</sub>-基は現在 知られている中で最も小さい臨界表面張力 (≈表面張力) である 6mN/m を示すことが知られている。もし固体表面上をこの CF<sub>3</sub>-基で完全に被 覆することができれば、最も水をはじく表面を得ることができると考 えられる。実際、そのような試みがなされ、水との接触角が約 120° という結果が得られている。すなわち、固体表面が平滑であれば、こ れ以上の接触角は得られないということになる。

しかし、実際にはこれを超える接触角を示す表面も知られており、 濡れには別な因子も関係していることを示している。それが、先に述 べた固体表面の微細構造である。固体表面に微細な凹凸構造が存在し、 その上に存在する液滴が固体表面と完全に接触する場合、「Wenzel の 理論」が適用される<sup>[12]</sup>。この"完全に接触する"という条件は、接触 角が 90°より小さくて濡れる表面の場合は当然満たされるが、はじく 表面の場合は必ずしも満たされない。撥水性の固体表面の細かな隙間 には、毛管現象のために液体は侵入できないからである。したがって、 Wenzel の理論が想定しているのは、比較的凹凸構造の小さな表面であ る。Wenzel の理論によると、凹凸表面上の接触角 θ<sup>\*</sup>は次式によって表 現される。

$$\cos \theta^* = r \cdot (\gamma_S - \gamma_{SL}) / \gamma_L = r \cdot \cos \theta \tag{5}$$

ここで r は表面積倍増係数であり、凹凸面の実表面積が平滑面(見かけの表面積)に比べて何倍大きいかを示している。Wenzelは、凹凸面の表面積が平滑面の r 倍になると、Young の式(4)における固体の表
面張力と固/液の界面張力に r を乗じる必要があるとして、式(5)を提案した。

一方、撥水性固体の凹凸を大きくしていくと、凹部まで液体が侵入 しなくなり、やがて固/液界面に空気が残留するようになり、撥水性が 向上していく。この場合、連続した固/液界面は、固体と空気が混在し た 複 合 面 に 液 体 が 接 す る 状 態 と な る 。 こ の よ う な 状 態 に は Cassie-Baxter 理論が適用される<sup>[13]</sup>。Cassie, et al.は異なる表面エ ネルギーをもつ2つの組成から成る複合表面の接触角について、以下 のような式を提案した。

$$\cos \theta^* = f_1 \cdot \cos \theta_1 + f_2 \cdot \cos \theta_2 \qquad (6)$$
$$f_1 + f_2 = 1$$

ここで、*f*, *θ* はそれぞれ液体と接する固体あるいは気体の表面分率 と、平滑固体表面での接触角である。大きな凹凸を有する固体表面で の濡れを、固体と気体の混合相とみなし、それぞれの寄与率が面積分 率に比例すると仮定し、気体と液体との接触角が 180°(cos180°=-1) であることから、(6)式に 180°を代入して以下の式を提示した。

$$\cos \theta^* = f \cdot \cos \theta + (1 - f) \cdot \cos 180^\circ$$
$$= f \cdot \cos \theta + f - 1 \tag{7}$$

ここで、*f*は液体との界面における固相の面積分率(*f*<1)である。 Wenzel, Cassie-Baxter のモデルの模式図を図 47 に示す。図 47-(a) が Wenzel モデル、図 47-(b)が Cassie-Baxter モデルであるが、撥水 性に及ぼす表面粗さの効果は、比較的粗さが小さい場合には式(5)で表 される Wenzel モードとなる。表面粗さが大きくなるに従い、凹部に空 気が残留するようになり、式(7)で表される Cassie-Baxter モードとな る。

Wenzel、Cassie-Baxter の式には実用上重要なパラメータが考慮さ れていない。実際の固体表面では組成や粗さの分布状態と表面形状に むらがあり、濡れ性に大きな影響を与える。例えば、撥水表面に親水 領域が細長い形状で分布している場合、親水部分の毛管力の増加およ びアスペクト比が高くなることで親水性の高い領域がつながって水に 濡れやすくなることにより、表面分率から予想される接触角よりも実 際の接触角の方が小さくなることがある<sup>[14]</sup>。また、表面粗さが同じで



図 47 濡れの模式図((a) Wenzel モデル,(b) Cassie-Baxter モデル)

も、表面構造の形状により撥水性が異なる場合がある。吉満等はダイ シングソーによりシリコン表面に様々なピッチと深さの溝を形成し、 その上にフルオロアルキルシラン (fluoroalkyl silane: FAS)をコー ティングしたモデル撥水表面を作製している<sup>[15]</sup>。このモデル表面では、 わずかな粗さの付与でWenzelモードからCassie-Baxterモードに移る。 これは、表面粗さが小さくても、表面構造の特徴から溝の底面のエッ ジ近傍には水が浸入しにくいため、固体/液体界面に空気が残留しやす くなるためと考えられている。

## 5-2 研究の目的

以上紹介したように、濡れ性と表面の微細構造との間には、密接な 関係がある。一方、これまで説明してきたように、本研究ではゾル-ゲル法に独自のオートクレーブ処理を導入することにより、屈折率を はじめとする膜の性状を任意に変更することが可能な、MgF<sub>2</sub>ナノ粒子 膜の作製技術を開発することに成功した。ゾルのオートクレーブ処理 温度を変えることにより、得られる膜の屈折率が変更可能なだけでな く、含まれる MgF<sub>2</sub>粒子の粒径や得られる膜の充填状態が変化し、膜表 面の形状・粗さも変更可能である。

加えて、結像光学系は汚れや水滴の影響を受けやすく、指紋や雨滴 により得られる像のコントラストの低下がしばしば問題になるが、そ のような問題を防止するために、近年フッ素系化合物を光学素子や光 学薄膜の表面に被覆することで、汚れや水滴の付着を防止する取り組 みがなされるようになった。代表的な例としては、自動車のフロント ガラスの撥水処理や、カメラのフィルターの防汚処理が挙げられる。

そこで本研究では、MgF<sub>2</sub>ナノ粒子膜の表面構造と、撥水処理の一つ である FAS 処理とを組み合わせ、主に水に対する静的および動的濡れ 性が、どのように変化するかを確認することとした。以下にその実験 手順と評価結果について詳しく説明する。

## 5-3 サンプル作製法

本実験で用いたサンプルの作製プロセスを図 48 に示す。まず、先に 述べた可視用反射防止膜用超低屈折率層の作製条件を踏襲し、100℃, 140℃および 180℃で 24 時間オートクレーブ処理を施した 3 種類のゾ ル(濃度2.0mass%)を用いて、合成石英ガラス基板上にナノ粒子膜を 形成した。100℃オートクレーブ処理ゾルは 1.5%に、140℃および 180℃ オートクレーブ処理ゾルについては 3.5%に濃度調整した後、スピンコ ートにより石英ガラス基板上に 2000rpm にて塗布・成膜を行った。バ インダー添加後もナノ粒子間の気孔は維持されていた[16]。さらに、膜 強度を向上するため、TEOSの 0.5mass%溶液をスピンコートにより塗布 した後、オーブンにて 150℃で 1 時間加熱処理した。次に、表面に吸 着した有機汚染物質を除去するため、水銀ランプで紫外線照射を行っ た後、蓋付きテフロン容器中にサンプルと FAS の一種であるトリデカ フルオロ-1, 1, 2, 2-テトラハイドロオクチルトリクロロシラン (tridecafluoro-1, 1, 2, 2-tetrahydrooctyltrichlorosilane: FAS13) を入れ、オーブンにて 150℃で 4 時間加熱した。図 49 に FAS13 の構造 を示す。本図が示す通り、FAS13はアルキル基上に13個のフッ素原子 を有し、ケイ素と結合していた塩素が脱離することにより、酸化物表 面とシランカップリング反応により共有結合を形成する。加熱処理後、 取り出したサンプルを、トルエン,アセトン,エタノールおよび水の 順で10分間ずつ超音波洗浄することで、サンプル表面に物理吸着した FAS13 の除去を行った。得られたサンプルは十分乾燥させた後、各種 評価に用いた。



図 48 FAS 処理 SiO<sub>2</sub>バインダー添加 MgF<sub>2</sub>ナノ粒子膜の作製手順

 $Cl_{Cl-Si-(CH_2)_2(CF_2)_5CF_3}$ 

図 49 FAS13 の分子構造模式図

SiO<sub>2</sub>上に化学結合した FAS は整然と基板上に並び、自己組織化単分 子膜(self assembled monolayer: SAM)を形成することが知られてい る<sup>[17]</sup>。図 50 に FAS13 により形成された SAM の模式図を示す。高い撥 水性を得るには、基板上にいかに欠陥なく整然と FAS 分子が立ってい るかが重要であるため、基板の洗浄は良好な撥水性を得る上できわめ て重要なプロセスとなる。



図 50 FAS13 により形成された SAM の模式図

また、図 51 に本実験で作製したサンプル断面の概念図を示す。オー トクレーブ処理温度に関わらず、各サンプルでは合成石英ガラス基板 上に MgF<sub>2</sub>ナノ粒子が空隙を残す形で堆積しており、個々の MgF<sub>2</sub>粒子を SiO<sub>2</sub> バインダーが結合することで、拭くこともできる膜強度を実現し ている (図 51-(a))。これらのサンプルに FAS 処理を施すことで、ナ ノ粒子表面に SAM が形成される (図 51-(b))。その際に、形成される SAM の膜厚は非常に薄いため、SAM 形成後にもナノ粒子膜の気孔は残っ ているものと推測される。また、FAS とのシランカップリング結合は MgF<sub>2</sub> 表面では形成されないことから、SAM はバインダー層表面でのみ 形成されていると考えられ、もしナノ粒子膜中でバインダーにより被 覆されていない MgF<sub>2</sub>表面が存在する場合、その部分には SAM は存在し ないものと推測される。さらに、ナノ粒子膜中の細孔の多くは媒質に 対して開いている状態 (開気孔) であると考えられ、撥水処理の際に FAS 分子は基板表面のバインダーにも到達しているものと考えられる。



図 51 FAS 処理 SiO<sub>2</sub>バインダー添加 MgF<sub>2</sub>ナノ粒子膜の構造模 式図 5-4 測定方法

まず、オートクレーブ処理後のゾルについて、粒度分布計((株)堀場 製作所 nano partica SZ-100)を用いて粒度分布の測定並びに平均粒子 径 D<sub>a</sub>の算出を行った。測定には得られた 2.0mass%のゾルをそのまま用 い、各サンプルについて 10 回ずつ測定を行い、平均値を求めた。

次いで、石英ガラス基板に成膜したナノ粒子膜サンプルに対し、走 査プローブ顕微鏡(SPM, エスアイアイ・ナノテクノロジーズ(株) Nanocute)を用いて表面観察を行った。また、得られた観察像から二乗 平均平方根(RMS)表面粗さ(S<sub>q</sub>)の算出および分水嶺法(watershed method)による平均粒子径(R<sub>a</sub>)の算出を行った。分水嶺法とは、画像 の2次元情報に高さ情報を加えることで、重なり合った粒子の輪郭抽 出を可能とし、個々の粒子を分離して粒子径を画像処理により求める 方法である。

さらに、接触角計(協和界面科学(株)DM-701)を用いて、各サンプル の水およびジョードメタン (diiodomethane)の静的接触角を測定し、 得られた接触角から表面自由エネルギーの算出を試みた。静的接触角 の測定では、一般的によく用いられる、2µ1の液滴を用い、各サンプ ルについて 10 回の測定から平均値を求め、そのサンプルの測定値とし た。

また、滑落法による水の転落角および前進角,後退角の測定も行い、 得られた値から水滴の付着エネルギーを計算した。転落角については、 サンプルステージを連続的に傾斜させ、水滴が動く直前の角度を転落 角と定義した。さらに、各測定条件について 10 回の測定を行い、その

平均値を転落角とした。水滴の付着力は以下の式(8)により算出した <sup>[18]</sup>。また、図 52 には転落角測定法および付着力算出法の模式図を示 す。

$$E = mg \sin \theta_{SL}/2\pi r \tag{8}$$

ここで、Eは付着エネルギー、rは液滴の基板との接触部分の半径、mは液滴の質量、gは重力加速度、 $\theta_{SL}$ は転落角である。基本的に式(8)にて算出した Eの単位は"N/m"であるが、分子と分母に mを乗ずることにより、値を変更することなく"J/m<sup>2</sup>"に変換可能である。



図 52 転落角測定法および付着力算出法の模式図

各サンプルの表面自由エネルギーは、以下に示す Owens-Wendt の式<sup>[19]</sup>を用いて算出した。

$$(1 + \cos \theta) \gamma_L^{total} = 2 (\gamma_S^d \gamma_L^d)^{1/2} + 2 (\gamma_S^h \gamma_L^h)^{1/2}$$
(9)

ここで、θは液体の静的接触角、γsは固体の表面自由エネルギー、γL は液体の表面自由エネルギー、total は表面自由エネルギーの総和、d は表面自由エネルギーの分散成分、h は表面自由エネルギーの極性成 分である。また、dおよびh成分は以下の過程のもとに算出された。

$$\gamma^{total} = \gamma^d + \gamma^h \tag{10}$$

また、y<sup>d</sup>と y<sup>h</sup>を算出するため、以下のような置換を行った。

$$x \equiv \gamma_{s}^{d1/2}, \ y \equiv \gamma_{s}^{h1/2}$$
(11)  

$$a_{I} \equiv \gamma_{LI}^{d1/2}, \ b_{I} \equiv \gamma_{LI}^{h1/2}, \ d_{I}$$

$$\equiv \gamma_{LI}^{total} (1 + \cos \theta_{LI})/2$$
(12)  

$$a_{2} \equiv \gamma_{L2}^{d1/2}, \ b_{2} \equiv \gamma_{L2}^{h1/2}, \ d_{2}$$

$$\equiv \gamma_{L2}^{total} (1 + \cos \theta_{L2})/2$$
(13)

ここで y<sub>L1</sub> は液体 1 の表面自由エネルギー、y<sub>L2</sub> は液体 2 の表面自由 エネルギーである。式(8)は式(10)~(12)を用いて以下のように表現で きる。

$$a_1 x + b_1 y \approx d_1 \tag{14}$$

$$a_2 x + b_2 y \approx d_2 \tag{15}$$

ここで  $x \ge 0$ ,  $y \ge 0$  である。 $x \ge y$ の解は、表 4 に示した水とジ ヨードメタンの表面自由エネルギーを用いて、式(14), (15)から求めた。

表 4 水とジョードメタンの表面自由エネルギー

	表面自由エネルギー		$(mJ/m^2)$
-	$\gamma^{d}$	$\gamma^{h}$	$\gamma$ total
水	21.8	51	72.8
ジヨードメタン	49.5	1.3	50.8

# 5-5 粒度分布評価

まず、使用するゾルに含まれる MgF<sub>2</sub>ナノ粒子の性状を把握するため、 オートクレーブ後の各ゾルを用いて粒度分布測定を行った。図 53 に 3 種のゾルについて評価結果を示す。100℃オートクレーブ処理ゾルに含 まれる MgF<sub>2</sub>粒子の粒度分布は 3 つのゾルの中でもっとも広く、その出 現頻度のピークは 15nm 付近にあった。分布については、大きな粒子径 側により広く分布しているように見えるが、小さい側の粒子はシング ルナノサイズで測定原理上感度が低いため、検出されなかったのでは ないかと考えられる。140℃オートクレーブ処理ゾルと 180℃処理ゾル では、分布の幅はほぼ同じであるが、出現頻度のピークはそれぞれ 28nm 付近と 45nm 付近であった。したがって、オートクレーブ処理温度が高 いほど、平均粒子径 D<sub>a</sub>は大きくなるといえる。

さらに、これらの測定値から、各ゾルに含まれる  $MgF_2$ 粒子の  $D_a$ (二 次粒子径)を求めた結果を表 5 に示す。100℃オートクレーブ処理ゾル に含まれる  $MgF_2$ 粒子の平均粒子径は 17.7nm であったが、140℃オート クレーブ処理ゾルでは 29.9nm となり、さらに 180℃オートクレーブ処 理ゾルでは 45.7nm となった。本結果より、オートクレーブ処理温度が 100℃から 180℃になることで、 $D_a$ はおよそ 3 倍になることがわかる。 オートクレーブ処理温度が高いほど大きな粒子径の  $MgF_2$ が得られると いう結果は、ゾルの調製濃度が違うものの、第 2 章で示した図 14 の TEM 観察結果や図 15 の粒度分布評価結果と一致する。なお、本評価で 得られた 180℃でオートクレーブ処理を行った  $MgF_2$ 粒子の  $D_a$ は、図 15 に示した 180℃でオートクレーブ処理した  $MgF_2$ 粒子の  $D_a$ よりも大きか

ったが、これはゾル調製濃度の違いによるものと考えられる。本評価 ではゾルの調製濃度が2.0%であったが、図 15 ではゾルの調製濃度は 1.0%であり、調製濃度が高いと一次粒子径が増加するとともに、オー トクレーブ処理中の一次粒子同士の衝突頻度が高くなり、二次粒子径 も増大するのではないかと考えられる。



図 53 ゾル中の MgF<sub>2</sub> 粒子の粒度分布測定結果(ゾル濃度: 2.0mass%,100℃:100℃オートクレーブ処理,140℃:140℃オー トクレーブ処理,180℃:180℃オートクレーブ処理)

表5 各ゾルに含まれる算術平均粒子径 D。

	オートクレーブ処理温度(℃)		
	100	140	180
$D_a$ (nm)	17.7	29.9	45.7

# 5-6 表面形状評価

先に述べた通り、表面の微細構造と濡れ性には密接な関係があるこ とから、各サンプルについて SPM による表面観察を行った。観察は FAS 処理の影響を確認するため、FAS 未処理サンプルと処理後のサンプル の両方について行った。図 54 に各サンプルの観察結果を示す。測定範 囲は全てのサンプルにおいて、1μm×1μm とした。100℃オートクレ ーブゾルから調製した膜は、全サンプルの中で最も微細な粒子により 形成されており、表面は最も滑らかであった。膜を構成する粒子はオ ートクレーブ処理温度が高いほど大きく、180℃オートクレーブ処理ゾ



Autoclaving Temperature / °C

図 54 MgF<sub>2</sub>ナノ粒子サンプルの SPM による FAS 処理前後の表面 形状比較 (測定範囲:1µm×1µm)

ルから調製した膜を構成する粒子が最も大きかった。また、表面の粗 さについても、粒子径と同様に、オートクレーブ処理温度が高いほど 大きかった。FAS 処理の影響については、処理前後での粒子径に明確 な差は認められなかった。

また、SPMにより求めた各サンプルの RMS 表面粗さ S<sub>a</sub>を図 55 に、分 水嶺法により求めた平均粒子径 R<sub>a</sub>を図 56 に示す。参考として、基板 である石英ガラスの測定値も合わせて示す。各サンプル共に、FAS 処 理前後での S<sub>a</sub>の差は認められず、FAS 処理は表面粗さに影響を与えな いことが図 55 からわかる。100℃オートクレーブ処理ゾルから調製し たサンプルの R<sub>a</sub>は約 5nm であったのに対し、140℃オートクレーブ処 理ゾルから調製したサンプルの R<sub>a</sub>は約 6nm とわずかに大きかった。さ らに、180℃オートクレーブ処理ゾルから調製したサンプルの R<sub>a</sub>は約 12nm であり、他のサンプルの 2 倍程度であった。粒度分布測定により 求めた平均粒子径 D<sub>a</sub>に比べると、各サンプルの S<sub>a</sub>は小さく、二次粒子 がある程度の密度で充填しているものと考えられる。また、粒度分布 測定で得られた 140℃オートクレーブ処理サンプルの D<sub>a</sub>は、100℃オー トクレーブ処理サンプルの D<sub>a</sub>よりも 1.5 倍ほど大きかったが、SPM に より求めた S<sub>a</sub>では 1nm ほどしか違いがなかったことは興味深い。

さらに平均粒子径  $R_a$ についてみてみると、オートクレーブ処理温度 が高いほど  $R_a$ も大きくなり、100℃オートクレーブ処理サンプルの  $R_a$ が約 17nm であったのに対し、140℃オートクレーブサンプルの  $R_a$ は約 20nm、180℃オートクレーブ処理サンプルの  $R_a$ は 20~23nm であった。 また、 $S_q$ 同様、FAS 処理前後での  $R_a$ の差は認められなかった。140℃オ ートクレーブ処理サンプルの  $R_a$ は、粒度分布測定で求めた  $D_a$ とほぼ一

致していたが、140℃オートクレーブサンプルと 180℃オートクレーブ サンプルでは、R<sub>a</sub>の値は粒度分布測定で求めた D<sub>a</sub>よりも小さな値とな った。これは、粒度分布計では凝集粒子を 1 つの粒子として検出して いるのに対し、SPM では二次粒子だけでなく、それを構成する一次粒 子も個別の粒子としてある程度分離することができるためではないか と考えられる。



図 55 SPMにより求めた FAS 処理前後の石英ガラスサンプル およびナノ粒子サンプルの表面粗さ S<sub>q</sub>



図 56 分水嶺法により求めたナノ粒子サンプルの平均粒子径 R<sub>a</sub>

## 5-7 光学特性評価

本実験に用いた MgF<sub>2</sub>ナノ粒子膜は、本来光学薄膜として開発された ものであることから、FAS 処理前後での外観および光学特性の比較を 行った。

図 57 に FAS 処理前後の各サンプルの外観写真を示す。比較サンプル として、成膜を行っていない石英ガラスも加えた。FAS 処理前(図 57-(a))はいずれのサンプルも透明であり、サンプル下の格子模様が 明瞭に確認できた。さらに、格子模様の黒い部分の濃度が維持されて いることから、光の散乱がないことがわかる。この優れた透過性は FAS 処理後も維持されており(図 57-(b))、格子模様の黒い部分の濃度も 特に低下しているようには見えなかった。このことから、FAS 処理は ナノ粒子膜の外観に大きな影響を与えないことが確認された。

さらに厳密な比較を行うため、FAS 処理後の各サンプルの透過率を 分光光度計で測定し、分光透過プロファイルの比較も行った。測定結 果を図 58 に示す。なお、膜厚については特に反射防止膜としての調整 を行っていないため、各サンプルの透過率のピーク波長は一致してい ない。各サンプルの透過率を見てみると、FAS 処理の有無にかかわら ず、ナノ粒子膜サンプルの透過率は測定波長範囲全体で石英ガラスの 透過率よりも高かった。このことから、ナノ粒子膜は全波長域に渡っ て反射防止膜として機能していることがわかる。ただし、石英ガラス の透過率に注目して FAS 処理前後の透過率を比較すると、800nm 付近 で約 1%、350nm 付近では 4%ほど FAS 処理後の透過率が低いことがわか る。これは FAS 処理により、わずかな散乱が発生していることを示し

ているものと考えられる。これはナノ粒子膜サンプルでも同様である が、ナノ粒子膜サンプルでは 800nm で約 1%、350nm 付近で約 2%と、石 英ガラスの低下量よりも小さかった。本来は表面積の大きいナノ粒子 膜サンプルの方が SAM の被覆面積も大きくなり、散乱も大きくなりそ うであるが、何らかの原因で SAM の被覆面積が石英ガラスより小さか った可能性も考えられる。



図 57 FAS 処理前後での  $MgF_2$  ナノ粒子膜サンプルの外観比較 ((a) FAS 処理前, (b) FAS 処理後, (1) 合成石英ガラスサンプ ル, (2) 100 Cオートクレーブ処理サンプル, (3) 140 Cオートク レーブ処理サンプル, (4) 180 Cオートクレーブ処理サンプル)



図 58 FAS 処理前後での  $MgF_2$ ナノ粒子膜サンプルの分光透過率 比較((a) FAS 処理前,(b) FAS 処理後,SiO<sub>2</sub> glass:合成石英 ガラスサンプル,100 $^{\circ}$ :100 $^{\circ}$ オートクレーブ処理サンプル, 140 $^{\circ}$ :140 $^{\circ}$ オートクレーブ処理サンプル,180 $^{\circ}$ :180 $^{\circ}$ オート クレーブ処理サンプル)

#### 5-8 静的濡れ性評価

図 59 に、各 FAS 処理サンプル表面に滴下した水滴の画像を示す。各 サンプルとも SAM が形成されたために撥水性を示したが、撥水の度合 いはサンプルにより異なっていた。興味深いのは、FAS 処理石英ガラ スサンプルの方が 100℃オートクレーブ処理サンプルよりも水をはじ いていたことである。ナノ粒子膜サンプル間の比較では、オートクレ ーブ処理温度が高いほど、撥水性も高くなっていた。



図 59 FAS 処理後の石英ガラスおよび  $MgF_2$ ナノ粒子膜サンプ ル上に滴下した水滴 (水滴サイズ:  $2\mu$ 1, (a) 石英ガラスサ ンプル, (b) 100 Cオートクレーブ処理サンプル, (c) 140 C オートクレーブ処理サンプル, (d) 180 Cオートクレーブ処理 サンプル) 次いで、表6に FAS 処理後の石英ガラスおよびナノ粒子サンプル上 に滴下した、水の接触角を示す。液滴サイズは2μ1とし、10回の左 右接触角の測定値から平均を求めた。

表 6 FAS 処理後の石英ガラスおよびナノ粒子サンプル上の水の接触角

液体		接触角(°)			
	基板 <sup>ª</sup>	100°C <sup>b</sup>	$140^{\circ} C^{\circ}$	180°C <sup>d</sup>	
水	120.7	114.7	123.0	133.5	

<sup>a</sup> 基板: 合成石英ガラス ( $\phi$  30mm, 厚さ=3mm)

<sup>b</sup>100℃:100℃オートクレーブ処理サンプル

°140°C:140°Cオートクレーブ処理サンプル

<sup>d</sup>180℃:180℃オートクレーブ処理サンプル

FAS 処理石英ガラス上の水の接触角は 121°であったが、これは西野 等の報告した値と一致しており<sup>[20]</sup>、FAS 処理が適切に行われたことを 示している。水滴の外観比較でも述べたが、100℃オートクレーブ処理 サンプルの水の接触角は、石英ガラスのそれよりも 6°ほど小さかっ た。仮に、ナノ粒子膜上の SAM の被覆率が 100%でない場合、部分的に 水に対する濡れ性の良い表面が残ることとなる。その場合、ナノ粒子 膜サンプルの濡れ状態は、水が微細構造の凹部に入り込むことで wenzel モードに近くなり、接触角は完全に FAS に覆われた平面よりも 小さくなる可能性がある。

さらに、図 60 には FAS 処理サンプルの表面粗さ S<sub>q</sub>と水の接触角との関係を示す。参考として、ナノ粒子膜を形成していない FAS 処理石 英ガラスサンプルの値も合わせてプロットした。



図 60 FAS 処理後の石英ガラスサンプルおよびナノ粒子サン プルの表面粗さ S<sub>q</sub> と水の接触角との関係 (SiO<sub>2</sub> glass:合成 石英ガラスサンプル, 100 °C:100 °C オートクレーブ処理サン プル, 140 °C:140 °C オートクレーブ処理サンプル, 180 °C:180 °C オートクレーブ処理サンプル)

先にも述べたように、FAS 処理石英ガラスサンプルの S<sub>q</sub>は 100℃オ ートクレーブ処理サンプルの S<sub>q</sub>より小さいにもかかわらず、大きな接 触角を示した。100℃オートクレーブ処理サンプルと 140℃オートクレ ーブ処理サンプルの S<sub>q</sub>は 1nm ほどしか違わなかったが、水の接触角は 140℃オートクレーブ処理サンプルの方が 8° ほど大きく明確な違いを 示した。180℃オートクレーブ処理サンプルは全サンプルの中で最も大 きな S<sub>q</sub> (12nm) を有していたが、水の接触角は 133.5° と、超撥水の 目安である 150°には及ばなかった。また、ナノ粒子膜サンプルにおいては、S<sub>q</sub>が大きいほど水の接触角は大きかったが、両者の間に直線 関係は認められなかった。

#### 5-9 動的濡れ性評価

これまで、静的な濡れ性の評価結果について述べたが、動的な濡れ 性も重要であるため、本章では動的濡れ性の評価結果について述べる。 主な動的濡れ性評価法には「拡張収縮法」と「滑落法(または傾斜法)」 があるが、本研究では窓に付着した雨滴の挙動などに近い滑落法を用 いて評価を行った。一般的に滑落法では 10~20µ1 の水滴を用いて評 価を行うことが多いため、本研究においても 20µ1 の水滴で測定を開 始したが、サンプルを 90°まで傾斜しても水滴がサンプル表面から滑 落しない場合が多かったため、水滴サイズを増加させて予備実験を行 い、最終的に 40µ1, 50µ1 および 60µ1 の水滴サイズで測定を行うこ ととした。

図 61 に FAS 処理後の各サンプルの転落角測定結果を示す。参考とし て、FAS 処理石英ガラスサンプルの転落角も合わせて示した。100℃オ ートクレーブ処理サンプルの転落角はいずれの水滴サイズにおいても 石英ガラスサンプルの転落角より大きく、また、オートクレーブ処理 温度が高いゾルより調製したサンプルほど大きな転落角を示した。 180℃オートクレーブサンプルでは、40µ1の水滴の転落角は、74.2° に達した。さらに、同じサンプル上では。水滴サイズが大きいほど小 さな転落角を示した。興味深いことに、表6と図 61の結果は、水の接 触角が大きいサンプルほど水滴の転落角が大きいことを示している。 一般的には、大きな接触角を有する表面は小さな転落角を示すという イメージがあるが、本実験では異なる結果が得られた。



図 61 FAS 処理後の石英ガラスサンプルおよびナノ粒子サンプル上の水滴の転落角(測定法:滑落法,ステージ:連続傾斜,基板:合成石英ガラス)

図 62 には、FAS 処理石英ガラスサンプルおよびナノ粒子サンプル上 に滴下した 40 µ 1 の水滴の、転落角測定における前進角・後退角変化 を示す。本データは、各サンプルの 10 回の測定の中から、最も平均値 に近い転落角を示した測定結果を、代表例としてそれぞれ抽出したも のである。サンプルの傾斜が進むと前進角と後退角は異なる値となる ため、水滴像からの接触角算出には、左右の接触角が異なる場合にも 適用可能な Tangent 法を用いた。また、図中に各サンプルの転落角を グレーの線で示し、グラフと共に各サンプルの転落角における水滴の 画像も合わせて示す。

サンプルステージの傾斜角が 0°の場合、前進角と後退角は等しく、 先に示した静的接触角の測定値と一致するように思えるが、実際には 一致しなかった。これは水滴サイズが異なると、重力の影響で接触角 も変わったからである。静的接触角測定では重力の影響を避けるため  $2\mu1$ の水滴を用いたが、図 62 に示した実験結果は水滴が転落するよ う 40 $\mu$ 1の水滴を用いており、重力で水滴が変形するために接触角は 小さな値となった。各サンプルとも傾斜角度が大きくなるにつれて、  $\theta_a$ は大きく、 $\theta_r$ は小さくなったが、 $\theta_a$ の増加は転落角に達する前に 停止した。一方、ナノ粒子サンプルでは、 $\theta_r$ の減少は転落角付近で屈 曲点を示し、屈曲点以降、変化はほぼなくなったが、石英ガラスサン プルでは、 $\theta_r$ の減少は転落角の手前でほぼ止まり、転落角以降で再び わずかな減少を示した。また、オートクレーブ処理温度に関わらず、 ナノ粒子サンプルの転落までの  $\theta_a \cdot \theta_r$ の変化の勾配はほぼ同じであ ったが、石英ガラスの勾配とは異なっていた。

オートクレーブ処理温度の違いに着目すると、オートクレーブ処理 温度が高いほど、転落角における  $\theta_a$ と  $\theta_r$ の差は大きくなる傾向が見 られた。これは、図 61 に示した通り、オートクレーブ処理温度が高い サンプルほど転落角が大きく、水滴の変形が大きいためであると考え られる。また、オートクレーブ処理温度にかかわらず、転落角付近で の  $\theta_r$ の値はおよそ 60°であった。



図 62 転落角測定における FAS 処理石英ガラスサンプルおよび ナノ粒子サンプル上の水滴の前進角・後退角変化(測定法:滑 落法,ステージ:連続傾斜,基板:合成石英ガラス,(a)石英 ガラスサンプル,(b) 100℃オートクレーブ処理サンプル,(c) 140℃オートクレーブ処理サンプル,(d) 180℃オートクレーブ 処理サンプル)

式(8)を用い、FAS 処理後の石英ガラスサンプルおよびナノ粒子膜サ ンプルの、転落角における水滴の付着エネルギーE を求めた結果を図 63 に示す。水滴サイズの影響を検討するため、E は 40,50 および 60 µ1 の各水滴サイズについて求めた。付着エネルギーは動的濡れ性の 尺度の一つとなると考えられ、そのような尺度は材料を窓材などとし て工業化する際に有用であると考えられる。転落角の大きさを反映し、 100℃オートクレーブ処理サンプルの E は、石英ガラスサンプルの



図 63 FAS 処理後の石英ガラスサンプルとナノ粒子サンプ ル上の水滴の付着エネルギー(測定法:滑落法,ステージ: 連続傾斜, 基板:合成石英ガラス)

Eより大きく、また、成膜に用いたゾルのオートクレーブ処理温度が 高いほど、大きな Eを示した。水滴サイズと Eの関係については、い ずれのサンプルにおいても、水滴サイズが異なってもほぼ同じ付着エ ネルギーが得られ、E は水滴サイズに依存しないことが明らかとなっ た。本結果は疋田等が報告した結果と一致していた<sup>[21]</sup>。

次いで、FAS 処理後の石英ガラスサンプルおよびナノ粒子サンプル について、 $\theta_a$ と  $\theta_r$ の差 $\Delta \theta$  を求めた結果を図 64 に示す。石英ガラス サンプルは、全サンプル中で最も小さな $\Delta \theta$  である 41° を示した。ナ



図 64 FAS 処理後の石英ガラスサンプルおよびナノ粒子サンプル の転落角における*A* θ 比較(基板:合成石英ガラス)

ノ粒子サンプルの $\Delta \theta$  はオートクレーブ処理温度が高いほど大きく、 100℃オートクレーブ処理サンプルの $\Delta \theta$  は 53°であったのに対し、 140℃オートクレーブ処理サンプルの $\Delta \theta$  は 57°であり、180℃オートク レーブ処理サンプルの $\Delta \theta$  は、すべてのサンプルの中で最も大きな 74°であった。

Dettre, et al.は、△ θ と表面粗さの間に強い関係性があることを 指摘している<sup>[22]</sup>。そこで、本研究では FAS 処理サンプルの表面粗さ S。 と△θとの関係について検討を行った。図 65 に示した通り、石英ガラ ス基板を含む FAS 処理サンプルのΔθは、サンプルの表面粗さに対し 比例関係にあることが確認された。表6および図60に示した通り、ゾ ルのオートクレーブ処理温度が高いほど、得られる膜の水の接触角は 大きかった。これらの結果を考え合わせると、本研究で作製したサン プルにおいては、表面粗さが大きいほど転落角が大きいといえる。こ のような濡れ性の原因は、ピン止め効果で説明できるかもしれない。 もし、大きなナノ粒子による凸構造が水滴に突き刺さった状態となっ た場合、サンプル表面は強いピン止め効果を示すと考えられる。図 66 には、異なる粒径を有する FAS 処理ナノ粒子膜サンプル上に置かれた 水滴の、濡れ状態の違いを説明するための模式図を示す。小さな粒径 を有する MgF。ナノ粒子膜(a)の場合も、大きな粒径を有する MgF。ナノ 粒子膜(b)の場合も、水滴は膜内部に吸い込まれず細孔中の空気と接し ていることから、濡れ状態としては Cassie-Baxter 状態であると考え られる。しかし、粒径の小さなサンプルの場合、その静的接触角から 推測すると、やや Wenzel 状態に近いのではないかと考えられる。粒径 の小さなナノ粒子サンプルの静的接触角は、粒径の大きなナノ粒子サ

ンプルの静的接触角よりも小さいにもかかわらず、粒径の小さなナノ 粒子サンプルの転落角は、大きなナノ粒子サンプルよりも小さかった。 これは、サンプルの表面粗さの違いによるものであると考えられる。 粒径の小さなナノ粒子サンプルでは、粒子による凸構造が水滴の中に 入り込んだとしても、あまり大きな抵抗とならず、ピン止め効果も小 さい。一方、大きな粒径のナノ粒子サンプルでは、粒子の凸構造が水 滴の中に深く入り込み、水滴が移動する際に抵抗となると考えられる。 すなわち、大きな粒径のナノ粒子膜は強いピン止め効果を示すと考え られる。また、ナノ粒子膜は多孔質であるため、多くのナノサイズの 気孔を有しており、それらのナノ気孔が転落角に影響を与えているこ とも考えられる。膜中のナノ気孔が毛管現象を発現して水を内部に吸 い込んだ場合、突起と同様にピン止め効果を発現する可能性がある。 水滴をサンプル上に長時間放置しても膜中に吸い込まれないことから、 その影響は大きくないとは考えられるが、毛管現象がピン止め効果に 寄与している可能性も考えられる。



図 65 FAS 処理後の石英ガラスサンプルおよびナノ粒子サンプルの表面粗さ S<sub>q</sub>と転落角における△*θ* との関係(基板: 合成石英ガラス)



図 66 異なる粒径を有する FAS 処理ナノ粒子膜サンプルの水に 対する濡れ状態の模式図((a) 粒径の小さな MgF<sub>2</sub>ナノ粒子サン プルの濡れ状態,(b) 粒径の大きな MgF<sub>2</sub>ナノ粒子サンプルの濡 れ状態)

ナノ粒子サンプルの濡れの状態をより詳細に検討するため、水およ びジョードメタンを用いて、各サンプルの表面自由エネルギーの算出 を試みた。ナノ粒子サンプルの表面自由エネルギーはサンプル固体表 面の本当の表面自由エネルギーではないが、見かけの表面自由エネル ギーとしてサンプルの表面性状を理解するのに役立つと考えた。測定 は石英ガラスおよびナノ粒子サンプルの他、石英ガラス基板上にバイ ンダー溶液を塗布したサンプルについても行った。これは、ナノ粒子 サンプルにおいて FAS が共有結合を形成するのは、MgF<sub>2</sub>表面ではなく バインダー表面だと考えられるからである。

FAS 処理後の各サンプルの、水およびジョードメタンの接触角を表 7 に示す。測定はいずれも 2µ1の液滴サイズで行い、同一サンプル上の 異なる 10 点での測定から平均値を求めた。FAS 処理石英ガラスの水の 接触角は 120.7°であり、ジョードメタンの接触角は 87.2°であった。 ナノ粒子サンプルについては、オートクレーブ処理温度が高いほど、 水の接触角もジョードメタンの接触角も高かった。100℃オートクレー ブ処理ゾルより調製したナノ粒子サンプルの水およびジョードメタン の接触角は、それぞれ 114.7°と 90.4°であった。また、180℃オート クレーブ処理ゾルより 調製したナノ粒子サンプルの水の接触角は 133.5°であり、ジョードメタンの接触角は 99.5°であった。バインダ ーコートサンプルの水の接触角は 106.7°であり、100℃オートクレー ブ処理ゾルより調製したナノ粒子サンプルの水の接触角よりも小さか った。
これら水およびジョードメタンの接触角の値を基に、FAS 処理後の 各サンプルの表面自由エネルギーを求めた結果を図 67 に示す。FAS 処 理石英ガラス基板の表面自由エネルギーは 14.3mJ/m<sup>2</sup>であり、FAS 処理 バインダーコートサンプルの表面自由エネルギーは 12.6m J/m<sup>2</sup> であっ た。100℃オートクレーブ処理ゾルから調製した FAS 処理ナノ粒子サン プルの表面自由エネルギーは 12.6mJ/m<sup>2</sup> でバインダーコートサンプル と同じ値であった。ナノ粒子サンプルの表面自由エネルギーはゾルの オートクレーブ処理温度が高いほど小さくなり、180℃オートクレーブ 処理ゾルから調製した FAS 処理ナノ粒子サンプルの表面自由エネルギ ーは 8.0mJ/m<sup>2</sup>であった。一方、表面自由エネルギーの成分比について みてみると、FAS 処理石英ガラスおよび 180℃オートクレーブ処理ゾル から調製した FAS 処理ナノ粒子サンプルでは、h 成分は存在しないと いう結果が得られたが、FAS 処理バインダーコートサンプルは 2.4mJ/m<sup>2</sup> と全サンプルの中で最も大きなh成分を示した。100℃オートクレーブ 処理ゾルから調製した FAS 処理ナノ粒子サンプルの h 成分は 0.5mJ/m<sup>2</sup> であった。バインダーコートサンプルの表面自由エネルギーで大きな h 成分が確認されたことから、このような h 成分はバインダー表面と 水との静電相互作用によるものと考えられ、バインダー表面に FAS 以 外の官能基が存在した可能性も考えられる。また、ナノ粒子サンプル の表面自由エネルギーは、表面粗さの増加と共に濡れの状態が Wenzel 状態寄りから Cassie-Baxter 状態寄りに変化することにより減少した のではないかと考えられる。

表7 FAS 処理後の各サンプルの水およびジョードメタンの接触角

液体	接触角(°)				
	基板 ª	バインダー <sup>b</sup>	100°C °	$140^{\circ}\mathrm{C}^{\mathrm{d}}$	180°C <sup>e</sup>
水	120.7	106.7	114.7	123.0	133.5
ジヨードメタン	87.2	92.6	90.4	96.0	99.5

<sup>a</sup> 基板:合成石英ガラス(φ30 mm,厚さ=3 mm)
 <sup>b</sup>バインダー:バインダーのみ塗布サンプル
 <sup>c</sup>100℃:100℃オートクレーブ処理サンプル
 <sup>d</sup>140℃:140℃オートクレーブ処理サンプル
 <sup>c</sup>180℃:180℃オートクレーブ処理サンプル



図 67 FAS 処理後の石英ガラスサンプル,バインダーコートサン プルおよびナノ粒子サンプルの表面自由エネルギー(基板:合成 石英ガラス)

異なる粒径を有する FAS 処理ナノ粒子サンプル上に置かれた水滴の 模式図を図 68 に示す。表面自由エネルギーが大きいことからわかるよ うに、小さな粒径のナノ粒子サンプル上の水滴は、FAS 処理により撥 水性を与えても、比較的多くのナノ粒子表面に接しており、それほど 大きな接触角は示さない。これに対し、大きな粒径のナノ粒子サンプ ル上の水滴は小さな表面自由エネルギーを示すことから、粒径が小さ い場合に比べて相対的に空気に触れている割合が増え、その結果、大 きな接触角を示すものと考えられる。ただし、図 69 に示すように、ナ ノ粒子に対するバインダーの被覆が完全でないなどの理由で、膜表面 の FAS による被覆が完全ではない場合、ナノ粒子の凸構造が水滴に突 き刺さったり、ナノ気孔に毛管現象で水が浸入したりすることにより、 大きなピン止め効果を示すものと考えられる。以上のことから、ナノ 粒子膜サンプルでより小さな転落角を得たい場合、粒径の大きなナノ 粒子膜に高い被覆率で FAS 処理による SAM を形成することが有効であ ると考えられる。



図 68 異なる粒径を有する FAS 処理ナノ粒子膜サンプル上の液 滴の模式図((a):粒径の大きな  $MgF_2$ ナノ粒子サンプル上の液滴, (b):粒径の小さな  $MgF_2$ ナノ粒子サンプル上の液滴)



図 69 FAS 処理後のナノ粒子膜の状態((a): バインダーが MgF<sub>2</sub> ナノ粒子全体を被覆している場合,(b): MgF<sub>2</sub>ナノ粒子の一部が 露出している場合)

#### 5-11 結論

本研究では、100℃, 140℃および 180℃でオートクレーブ処理を行 った MgF, ゾルに TEOS をバインダーとして添加し、それらを合成石英 ガラス基板上に塗布することにより、ナノ粒子膜を形成した。次いで、 それらのサンプルに FAS13を用いて SAMを形成し、撥水性を与えた後、 静的および動的濡れ性の評価を行った。オートクレーブ後のゾルに含 まれる MgF,ナノ粒子の粒度分布は 100℃処理サンプルで最も広く、ま た、平均粒子径D。は、オートクレーブ処理温度が高いほど大きかった。 得られたナノ粒子サンプルは、FAS 処理により単波長側での透過率が 若干下がったものの、いずれも透明で、外観からは FAS 処理の有無を 区別することはできなかった。SPM で膜の RMS 表面粗さ S<sub>q</sub>の測定を行 ったところ、100℃オートクレーブ処理ゾルから調製したサンプルでは 5.09nm であったのに対し、180℃オートクレーブ処理ゾルから調製し たサンプルでは 12.1nm と、オートクレーブ処理温度が高いほど S<sub>a</sub>が 大きくなっていることが確認された。また、FAS 処理は S<sub>q</sub>に影響を与 えないことも確認された。得られたサンプルの水およびジョードメタ ンの静的接触角を測定したところ、いずれの液体に対しても、ナノ粒 子サンプルではゾルのオートクレーブ処理温度が高いほど、大きな接 触角を示した。ただし、水については、100℃オートクレーブ処理ゾル から調製した FAS 処理ナノ粒子サンプルの接触角(114.7°)は、FAS 処理石英ガラスサンプルの接触角(120.7°)よりも、若干小さかった。 この原因として、ナノ粒子サンプルの FAS 被覆率が 100%に達していな いことが考えられる。一方、滑落法による水に対する動的濡れ性評価

では、オートクレーブ処理温度が高いほど、大きな転落角を示した。 これは、ゾルのオートクレーブ処理温度が高いほど、言い換えると、 膜の表面粗さ S<sub>q</sub>が大きいほど水滴が滑落しにくいということである。 その原因として、膜表面の微細構造が水滴に入り込むことによるピン 止め効果が考えられた。この傾向は、水滴サイズを変えても変わらず、 同じナノ粒子サンプル上であれば、水滴の付着エネルギーは水滴サイ ズに関わらずほぼ同じであった。さらに、転落角の測定結果から θ<sub>a</sub> と θ<sub>r</sub>の差Δθを求めたところ、FAS 処理石英ガラスのΔθ が最も小さ く、ゾルのオートクレーブ処理温度が高いサンプルほど大きなΔθ を 示した。また、膜の表面粗さとΔθ との関係を調べたところ、両者の 間には比例関係があることが確認された。

- [1] W. Barthlott and C. Neinhuis, Planta, **202**, 1-8 (1997).
- [2] L. Feng, Y. Zhang, J. Xi, Y. Zhu, N. Wang, F. Xia, L. Jiang, Langmuir, 24, 4114-4119(2008).
- [3] P.B. Clapham and M.C. Hutley, Nature, **244**, 281-282 (1973).
- [4] S. A. Wainwright, F. Vosburgh and J. H. Hebrank, Science, 202, 747-749 (1978).
- [5] O. Watanabe, K. Kitamura, H. Maenami, H. Ishida, J. Am. Ceram. Soc., 84, 2318-2322 (2001).
- [6] T. Onda, S. Shibuichi, N. Satoh, and K. Tsujii, Langmuir,
   12, 2125-2127 (1996).
- [7] H. Li, X. Wang, Y. Song, Y. Liu, Q. Li, L. Jiang, and D. Zhu,Angew Chem. Int. Ed., 40, 1743-1746 (2001).
- [8] K. Tadanaga, K. Kitamuro, A. Matsuda and T. Minami, J. Sol-Gel Sci. Tech., 26, 705-708 (2003).
- [9] E. Hosono, S. Fujihara, I. Honma, and H. Zhou, J. Am. Chem. Soc., 127, 13458-13459 (2005).
- [10] M. Nicolas, F. Guittard, and S. Geribaldi, Angew Chem. Int. Ed., 45, 2251-2254 (2006).
- [11] T. Young, Trans. Faraday Soc., 96A, 65-87 (1805).
- [12] R. N. Wenzel, Ind. Eng. Chem., **28**, 988-994 (1936).
- [13] A. B. D. Cassie, and S. Baxter, Trans. Faraday Soc., 40, 546-551 (1944).

- [14] N. Arimitsu, A. Nakajima, Y. Kameshima and K. Okada, Abst. Annual Meeting of the Ceram. Soc. Jpn., 71 (2007).
- [15] Z. Yoshimitsu, A. Nakajima, T. Watanabe and K. Hashimoto, Langmuir, 18, 5818-5822 (2002).
- [16] T. Murata, H. Ishizawa and A. Tanaka, Appl. Opt., 50, C403-C407 (2011).
- [17] K. Kojio, A. Takahara, K. Omote, and T. Kajiyama, Langmuir,16, 3932-3937 (2000).
- [18] E. Wolfram and R. Faust, "Wetting, Spreading and Adhesion",Ed. by J. F. Padday Academic Press, London, (1978) pp. 213-222.
- [19] D. K. Owens and R. C. Wendt, J. Appl. Polym. Sci., 13, 1741-1747 (1969).
- [20] T. Nishino, M. Meguro, K. Nakamae, M. Matsushita and Y. Ueda, Langmuir, 15, 4321 (1999).
- [21] M. Hikita, K. Tanaka, T. Nakamura, A. Takahara and T. Kajiyama, J. Surf. Sci. Soc. Japan, 26, 559-563 (2005).
- [22] R. H. Dettre, R. E. Johnson Jr., Adv. Chem. Ser., 43, 136-144 (1963).

#### 総括

6-1 本論文の総括

第1章では、本研究の背景、目的および本論文の構成について述べた。

第2章「超低屈折率層形成技術の確立」では、超低屈折率膜実現の ための成膜法の検討、使用する膜物質の選定および屈折率低減の方策 について述べた。

本研究では、膜の構造を多孔質とすることで見かけの屈折率を低減 することとし、これまで報告のあった多孔質膜の構造の中から、ナノ 粒子が空隙を残しつつ膜の深さ方向に対して均一に堆積した構造を実 現することとした。また、成膜法としては酸化物多孔質膜の作製法と して実績のあるゾルーゲル法を、膜物質としては真空紫外領域でも高い 透過率を有し、アルカリ土類フッ化物の中でも屈折率が低い MgF<sub>2</sub>を選 択した。さらに、ゾルーゲル法による MgF<sub>2</sub>ナノ粒子合成プロセスに、 独自の工夫としてオートクレーブ処理を導入することとした。その結 果、MgF<sub>2</sub>合成プロセスとオートクレーブ処理を組み合わせることで、 一次粒子が空隙を残してネックで繋がった二次粒子が形成され、さら に二次粒子が空隙を残して均一に堆積することで、193nm で 1.25 以下 という超低屈折率が得られるとともに、半導体露光装置でも十分使用

可能なほど光学損失が小さく、不均質の無い膜が形成可能となること を見出した。得られるナノ粒子膜の屈折率は、オートクレーブ処理温 度を室温から180℃まで変更することにより、1.41~1.17(λ=193nm) の範囲で変更することが可能であった。さらに、オートクレーブ処理 がゾルの粘度を低下させることにより、制御可能な膜厚範囲を拡大す ることも見出した。

第3章「紫外光用反射防止膜の作製」では、ゾル-ゲル法を用いて形成した MgF<sub>2</sub>ナノ粒子層を有する、紫外光用反射防止膜の作製および評価結果について述べた。

ゾルーゲル法により形成した MgF<sub>2</sub> ナノ粒子膜は、真空紫外領域にお いても 1.30 以下の超低屈折率を有しており、膜厚は塗布に用いるゾル の濃度を変更することで、屈折率を変化させることなく調整すること が可能であった。CaF<sub>2</sub>基板両面に CaF<sub>2</sub>の屈折率の平方根に一致するナ ノ粒子単層膜を形成することにより、真空紫外領域においても 99%を 超える高い透過率が得られた。また、屈折率 1.18 (λ = 193nm)の MgF<sub>2</sub> ナノ粒子膜を最上層に配した 5 層反射防止膜を、石英ガラス基板上に 形成したサンプルでは、193nmの光線に対し、入射角 58° で 0.6%とい う、従来反射防止膜の 1/3 に相当する低い反射率が得られた。また、 単層膜サンプルに対する ArF レーザー (λ = 193nm)の連続照射では、 半導体露光装置の投影レンズに十分使用可能な高いレーザー耐久性が 確認された。さらに、φ300mm までの基板で良好な膜厚の面内膜厚均 ーが確認され、基板のサイズが膜厚に影響を及ぼさないことも確認さ れた。これらの優れた特性により、本手法で作製した MgF<sub>2</sub>ナノ粒子膜

を用いた反射防止膜は、ArF 半導体露光装置の投影レンズに採用となった。

第4章「可視光用反射防止膜の作製」では、バインダーを加えた MgF<sub>2</sub> ナノ粒子層を有する可視光用反射防止膜の作製および評価結果につい て述べた。

MgF<sub>2</sub>ナノ粒子膜にSiO<sub>2</sub>バインダーを添加することで膜強度を向上し、 工程適用性を向上することで、量産にも対応可能な 1.30 以下の超低屈 折率を有する膜を形成可能なプロセスを確立した。また、紫外光用反 射防止膜と同様に、ゾルの調製条件を変更することで任意の屈折率を 有する膜の形成が可能であり、この性質を利用することで、特定波長 で反射率が0%となる単層反射防止膜を、種々の基板上に形成すること ができた。また、本技術で形成した超低屈折率層を多層反射防止膜の 最上層に配することにより、反射防止波長範囲の広帯域化、帯域内で の低反射率化、および反射防止可能光線入射角の広入射角化が可能と なった。例えば、最上層にナノ粒子層を有する 9 層反射防止膜では、 波長 650~450nm の範囲で 0.0098%という極めて低い平均反射率が得ら れた。このような特徴はデジタルカメラの交換レンズの性能向上に好 適であることから、超低屈折率層を導入した反射防止膜を一眼レフカ メラ用の交換レンズに適用し、撮影を行ったところ、顕著なゴースト・ フレアー低減効果を確認することができた。その優れた反射防止性能 により、本技術を導入した可視光用反射防止膜は「ナノクリスタルコ ート」として、2005年に望遠レンズに搭載された。本レンズは、1.30 以下の超低屈折率層を有する反射防止膜が適用された、世界初のカメ

ラ用レンズである。現在では、ナノクリスタルコートを搭載した交換 レンズは 20 機種に達しているほか、顕微鏡の対物レンズにも採用され、 顕微鏡による観察像のコントラスト向上に貢献している。

第5章「ナノ粒子膜の濡れ性制御」では、FAS 処理により撥水性を 付与したナノ粒子膜サンプルの静的・動的濡れ性について評価を行っ た結果について述べた。

濡れをコントロールするには材料表面の化学的組成だけでなく、表 面の微細構造を制御することが重要である。そこで、本研究では MgF。 ナノ粒子膜の成膜技術と、撥水性を付与するための FAS 処理とを組み 合わせ、膜の表面粗さ S。と静的・動的濡れ性との関係について評価を 行った。ゾルのオートクレーブ処理温度を上げると、MgF<sub>2</sub>ナノ粒子の 平均粒子径 D』は大きくなり、得られる膜の S。も大きくなった。得られ たナノ粒子膜サンプルはいずれも透明で、FAS 処理による明確な外観 の変化は認められず、S。も変化しなかった。FAS 処理ナノ粒子膜サン プルの水およびジョードメタンの静的接触角は、オートクレーブ処理 温度が高いほど大きくなった。ただし、100℃オートクレーブ処理ゾル から調製したサンプルの水の接触角は、FAS 処理石英ガラスサンプル の接触角よりもわずかに小さかった。この原因として、ナノ粒子サン プルの FAS による被覆が完全ではないことが考えられた。一方、滑落 法による動的濡れ性評価では、ゾルのオートクレーブ処理温度が高い ほど、水の転落角が大きくなった。その原因として、膜表面の微細構 造が水滴に入り込むことによるピン止め効果が考えられた。また、水 滴の付着エネルギーについては、同じサンプル上であれば、水滴サイ

ズに関わらずほぼ同じ値が得られた。さらに、転落角の測定結果から 前進角と後退角の差Δθを求めたところ、FAS処理石英ガラスのΔθが 最も小さく、ゾルのオートクレーブ処理温度が高いサンプルほどΔθ も大きかった。膜の表面粗さとΔθ との間には比例関係があることが 確認された。

本章「総括」においては、本論文の各章で述べた研究成果を要約して述べた。

6-2 今後の反射防止膜の発展について

近年、反射防止技術は性能的に飽和状態にあり、成熟技術と捉えら れていたが、本技術の登場によって性能面でのブレークスルーをもた らすことができたことから、今後、光学薄膜の研究開発を活性化する ための布石になるものと期待している。また、これまで主に大型基板 への低コスト成膜法として捉えられてきたウェットプロセスに対して、 光学薄膜の高精度化・高性能化への応用の道を開いたことは、産業的 に見ても意義深い成果であると考える。実際、本研究の成果が製品に 適用されてから数年後には、他社からもウェットプロセスにより形成 した超低屈折率膜を用いた高性能反射防止膜が登場してきており、今 後の薄膜業界の動向が注目される。また、研究分野ではインプリント を中心として様々な反射防止構造の形成法が検討されており、より革 新的な技術が確立・製品適用されるものと期待している。現在、一般 的な反射防止膜の平均反射率は 0.2~0.5%程度であるが、近い将来、1 桁低い反射率が一般的になる日が来るかもしれない。特に、太陽光発 電を中心としたエネルギー分野では、エネルギーの変換効率を上げる ために太陽電池の光電変換効率だけでなく、システム全体の効率向上 も図られており、超低反射表面の実現は重要な開発項目の一つとなっ ている。今後、エネルギー分野における高性能反射防止膜の開発ニー ズが、さらに高まっていくことも十分考えられる。

現在、本技術を適用した製品は、半導体露光装置用投影レンズ,デ ジタルカメラ用交換レンズおよび顕微鏡用対物レンズであるが、その 優れた反射防止性能,基板形状適応性および高い生産適用性は、あら

ゆる光学製品の性能向上にきわめて有効であると考えられることから、 今後も本技術の特長を生かし、さらなる適用拡大に努めていきたいと 考えている。

## 著者発表の論文・特許など

#### 公表論文

- 1. T. Murata, H. Ishizawa, I. Motoyama and A. Tanaka, J. Sol-Gel Sci. Technol., "Investigations of  $MgF_2$  optical thin films prepared from autoclaved sol," **32**, 161-165 (2004).
- T. Murata, H. Ishizawa, I. Motoyama and A. Tanaka, "Preparation of high-performance optical coatings with fluoride nanoparticle films made from autoclaved sols," Appl. Opt., 45, 1465-1468 (2006).
- 3. T. Murata, H. Ishizawa, I. Motoyama and A. Tanaka, "Investigation of  $MgF_2$  optical thin films with ultralow refractive indices prepared from autoclaved sol," Appl. Opt., 47, 246-250 (2008).
- 4. T. Murata, H. Ishizawa, and A. Tanaka, "High-performance antireflective coatings with a porous nanoparticle layer for visible wavelengths," Appl. Opt., **50**, C403-407 (2011).
- 5. T. Murata, J. Hieda, N. Saito and O. Takai, "Wettability of MgF<sub>2</sub> Porous Nanoparticle Layers Covered with Fluoroalkylsilane Self-Assembled Monolayer," J. Ceram. Soc. Japan, 119, 591-594 (2011).
- T. Murata, J. Hieda, N. Saito and O. Takai, "Wettability Characterization of Transparent MgF<sub>2</sub> Nanoparticle Coatings with SiO<sub>2</sub> Binder Covered with Fluoroalkylsilane Self-Assembled Monolayers," J. Sol-Gel Sci. Technol., 60, 125-130 (2011).

#### 投稿中論文

1. T. Murata, J. Hieda, N. Saito and O. Takai, "Preparation and wettability examinations of transparent  $SiO_2$ binder-added MgF<sub>2</sub> nanoparticle coatings covered with fluoro-alkyl silane self-assembled monolayer," Appl. Opt., under review.

## 参考論文

1. H. Ishizawa, S. Niisaka, T. Murata and A. Tanaka, "Preparation of  $MgF_2$ -SiO<sub>2</sub> thin films with a low refractive index by a solgel process," Appl. Opt., **47**, 200-205 (2008).

### 雑誌報告

- 「"ナノ粒子膜"による高性能光学薄膜の作製」
   村田 剛,日本機械学会誌,111,54 (2008).
- 「フッ化物ナノ粒子を用いた高性能光学薄膜の開発」 村田 剛, 0 plus E, 345, 855-859 (2008).
- 「フッ化物ナノ粒子を用いた超高性能反射防止膜の開発」
   村田 剛,光学,40,17-23 (2011).
- 「ナノ粒子を用いた高性能反射防止膜"ナノクリスタルコート"の開発」
   村田

剛, 日本写真学会誌, 73, 243-248 (2010).

国内学会

- 第51回応用物理学関係連合講演会 光設計研究グループシン ポジウム 招待講演(2004)
- 日本光学会主催年次学術講演会(0J2004)光設計賞授賞式 光 設計大賞受賞講演(2004)
- 3. 日本光学会主催 第34 回光学シンポジウム (2009)
- 4. 光設計研究グループ主催 第43 回研究会 (2009)
- 2010年度日本写真学会年次大会 日本写真学会技術賞受賞記 念講演(2010)

国際学会

1. "Investigations of  ${\rm MgF}_2$  Optical Thin Films Prepared from Autoclaved Sol"

T. Murata, H. Ishizawa, I. Motoyama and A. Tanaka XII International Workshop on Sol-Gel Science and Technology (2003)

- "Preparation of high performance optical coatings with fluoride-nano-particle films made from autoclaved sols"
   T. Murata, H. Ishizawa, I. Motoyama and A. Tanaka Topical Meeting on Optical Interference Coatings (2004)
- 3. "Investigations of MgF<sub>2</sub> optical thin films with ultra-low refractive indices prepared from autoclaved sols"
  T. Murata, H. Ishizawa and A. Tanaka
  Topical Meeting on Optical Interference Coatings (2007)

- 4. "Designs of Antireflective Coatings with Ultra-Low Refractive Index Layers for ArF Laser" T. Murata, H. Ishizawa and A. Tanaka 6th International Conference on Optics-Photonics Design & Fabrication 主催:日本光学会 光設計研究グループ (2008)
- 5. "New Antireflective Coatings with Porous Nanoparticle Layers"

T. Murata

7th International Conference on Optics-Photonics Design & Fabrication 主催:日本光学会 光設計研究グループ 招待講演 (2010)

#### 賞歴

- 第7回(2004年)光設計大賞「フッ化物ナノ粒子膜による高性 能光学薄膜の作製」 主催:日本光学会 光設計研究グループ
- 2. 2010 年度 日本写真学会技術賞「ナノクリスタルコートの開発」
   主催:日本写真学会

日本特許

- 1. 特開平 10-221502
- 2. 特開平 10-319209
- 3. 特開 2000-85025
- 4. 特開 2002-296403
- 5. 特開 2004-302112

- 6. 特開 2004-302113
- 7. 特開 2005-114400
- 8. 特開 2005-284040
- 9. 特開 2006-301519
- 10. 特開 2007-93894
- 11. 特開 2008-233284
- 12. 特開 2009-008901
- 13. 特開 2010-015186

国際特許

- 1. W001/023914
- 2. W002/018982
- 3. W02006/030848

著書

 監修 西井準治・菊田久雄:"ナノ構造光学素子開発の最前線" 3章「フッ化マグネシウムナノ粒子を用いたナノクリスタルコ ートの作製」, CMC 出版, pp. 46-58 (2011)

# 謝辞

本論文をまとめるにあたり、始終懇切なるご指導とご鞭撻を賜りま した名古屋大学大学院工学研究科の高井治教授に、心からの感謝の意 を表します。また、稗田純子助教(現 東北大学金属材料研究所)には、 濡れ性評価用サンプルの作製において多大なるご協力を頂きました。 深く感謝致します。

また、本論文に対して、同大学エコトピア科学研究所の齋藤永宏教 授、同大学大学院工学研究科の興戸正純教授、梅原徳次教授、黒田健 介准教授より、副査として論文内容についてご討論頂くとともに、有 益なるご助言を頂きました。厚く御礼申し上げます。

さらに、本技術の製品適用にご尽力いただき、なおかつ名古屋大学 大学院への入学の機会を与えて下さった、(株)ニコンの長塚淳本部長 および秋山貴之マネジャーに心から感謝致します。

研究を進めるにあたっては、サンプル作製および評価において、(株) ニコンの米山健司様や平木信一様をはじめとするナノ粒子膜チームの メンバーに、多大なるご協力を頂きました。皆様の協力なしには、本 研究の成果をまとめることはできませんでした。加えて、エスアイア イ・ナノテクノロジー(株)の辻川葉奈様には、SPM によるサンプル の表面観察において、ご協力と的確なアドバイスを頂きました。心よ り御礼申し上げます。

投稿論文の執筆にあたっては、上智大学の Frank Scott Howell 教授 および(株)ニコン・アンド・エシロールインターナショナル・ジョ イントリサーチセンターの今野邦男様に英語の校正をして頂くととも

に、細やかなアドバイスを頂きました。お二人のご支援がなければ、 論文の投稿により多くの時間を費やさなくてはならなかったでしょう。 心から感謝致します。

本論文の執筆にあたっては、(株) ニコン・アンド・エシロールイン ターナショナル・ジョイントリサーチセンターの田中彰社長ならびに 石川彰様より、適切なご助言を頂くとともに、 常に暖かい励ましを頂 きました。特に田中社長には、研究開始当初より変わらぬご指導・ご 鞭撻を頂き、また、学位の取得を強く勧めて頂きました。深く感謝致 します。

最後に、学位取得と博士論文の執筆に理解を示し、健康に気遣って 陰で支えてくれた妻に、心から感謝の意を表します。

2012年3月